

由远场可变孔径法测得的互补孔径功率传输函数 $F(\theta)$ 确定模场直径 ($2w_0$) 的等效式为:

$$2w_0 = \frac{\sqrt{2}\lambda}{\pi} \left[\int_0^\infty F(\theta) \sin 2\theta d\theta \right]^{\frac{1}{2}} \quad (4.53)$$

式中: λ — 测量波长;

互补孔径功率传输函数 $F(\theta)$ 的定义为:

$$F(\theta) = 1 - \frac{P(\theta)}{P_{\max}} \quad (4.54)$$

式中: P_{\max} — 通过最大孔径的光功率;

θ — 偏离光纤轴的远场测量角。

● 近场扫描法

由近场扫描法测得的近场光强度分布 $F(r)$ 确定模场直径 ($2w_0$) 的等效式为:

$$2w_0 = 2 \left[2 \frac{\int_0^\infty r \cdot F^2(r) dr}{\int_0^\infty r \left(\frac{dF(r)}{dr} \right)^2 dr} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (4.55)$$

式中: r — 径向坐标。

下面分别介绍远场扫描法、可变孔径法、近场扫描法的测量原理、试验装置、试验程序等。

(1) 远场扫描法

① 测量原理

远场扫描法是 ITU-T G. 650 规定的单模光纤色散测量的基准试验方法。它是直接按照式 (4.51) 模场直径定义由远场光强分布 $F(\theta)$ 来确定模场直径的。式 (4.51) 中的积分上下限为 0 到 $\pi/2$, 但我们应该理解为增加了自变量的范围带来的积分限的取舍。当自变量 θ 的最大物理值为 $\pi/2$ 时, 在 θ 达到 $\pi/2$ 之前。被积函数迅速趋于零。由积分上下限的取舍引起的模场直径确定的相对误差, 将在试验装置中有关扫描检测器作用中讨论。

模场直径的测量原理是将光纤的注入端与入射光纤对准, 光纤输入端对中探测器件, 以固定的程序启动扫描探测器, 特别是要保证扫描探测器通过模场中心, 探测器将各个角度上探测到的功率转化为电信号, 由放大器放大后送入信号处理部分。与相应的测角仪的角信号进行处理后送入计算机就可得出远场光强度分布 $F(\theta)$, 再按定义式 (4.51) 编制好的积分程序计算出光纤的模场直径。

② 试验装置

远场扫描法测量单模光纤模场直径的试验装置, 如图 4.29 所示。远场扫描

法试验装置主要由光源、扫描探测器和信号处理等部分组成。

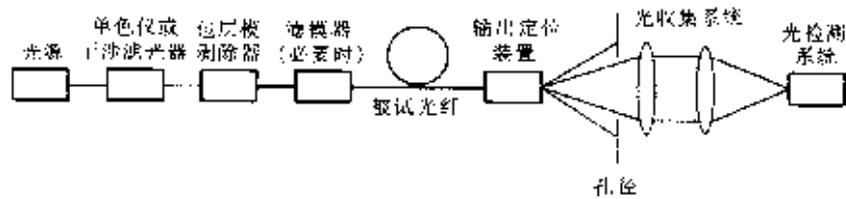


图 4.29 远场扫描法试验装置

A. 光源

在完成整个测量过程中，光源位置、光强和波长应保持稳定。所选择的光源光谱特性应消除多模工作。光源谱线宽度 FWHM 应不大于 10nm。

B. 调制

通常调制光源的目的是为了改善接收器的信噪比。这时探测器应与光源调制频率同步的信号处理系统相连。检测系统应具有良好的线性灵敏度特性。

C. 注入条件

所用的注入条件应保证激励起基模 (LP_{01})。例如，适宜的注入方法是用尾纤或合适的光学透镜系统来激励被测光纤。小心不要让高阶模传导。为此目的，需要在被测光纤上松绕一个合适半径的圆圈或加入其他类型的滤模器来消除高阶模。

D. 包层模剥除器

应采取措施来防止包层模的传导和被探测到。

E. 试样

被测试样应是一段短光纤。如果所用的试样是具有预涂覆层的光纤，那么插入包层模剥除器的那部分光纤的预涂覆层应去除。试样光纤的两端面应清洁、平滑且光纤轴垂直。我们建议试样光纤两端面应平整且与光纤轴的垂直度小于 1%。

F. 扫描检测器

用来对光纤远场光强分布进行扫描的检测器是一个具有针孔或一个带尾纤的扫描光电探测器。探测器离开光纤输出端面至少 10mm，其光敏面的远场张角不应太大，否则会引起大的测量误差。为此要求探测器光敏面离光纤输出端的距离 S 大于 $40w_{ob}/\lambda$ ， $2w$ 为估计的被测光纤模场直径， b 为探测器光敏面的直径， λ 为工作波长。

测量系统的最小动态范围应为 50dB。对 G. 652 光纤和 G. 653 光纤，上述动态范围分别对应于 20° 和 25° 的最大扫描半角或者更大。如果动态范围减小，就会带来测量误差。例如，对 G. 652 光纤只要 30dB 动态范围 (12.5° 半张角)；对 G. 653 光纤只要 40dB 动态范围 (20° 半张角) 就会使模场直径测量误差大于 1%

%。

G. 探测器

选用一合适的探测器。探测器应具有线性灵敏度特性。

H. 放大器

使用一个放大器来放大信号电平。

I. 获得数据

测得的信号大小应予以记录并进行合适的处理。

③ 试验程序

将制备好的光纤试样安放至试验装置中，借助注入光束来对准光纤光注入端。用试样光纤输出端对准光探测器来获得最大光功率。接着的试验程序如下：启动扫描检测器，以不大于 0.5° 的固定步长进行量扫描测量出远场光强分布 $F(\theta)$ 。按式 (4.51) 计算出被测光纤的模场直径。

(2) 可变孔径法

① 测量原理

虽然远场扫描法是测量模场直径的基准试验方法，尽管其测量精度高，但是由于动态范围大，对系统要求高，实现的技术难度大，因而实际上远场扫描法很少使用。人们更常用的是替代试验法，特别是可变孔径法。可变孔径法是测量单模光纤模场直径的第一替代试验法。

测量单模光纤模场直径的可变孔径法的测量原理是将光源发出的光耦合到被测单模光纤中，经滤模和剥除包层模后，将光纤的出射端面对准光学系统的光轴。光学系统由微调架、透镜系统和光探测器组成。在光纤端面与透镜之间，装有一个与光学系统光轴垂直的转盘。转盘上开有至少 12 个以上直径不同的圆孔，要求这些圆孔半径对应的远场半张角的数值孔径覆盖 $0.02 \sim 0.25$ 的范围，对 G.653 光纤，则数值孔径覆盖范围为 $0.02 \sim 0.4$ ，光学系统的孔径更大一些。测量单模光纤模场直径时，将被测光纤放入测量装置依次转动转盘，测量通过每一个孔径 θ 的光功率 $P(\theta)$ ，求出透射互补函数 $F(\theta)$ ：

$$F(\theta) = 1 - \frac{P(\theta)}{P_{\max}} \quad (4.56)$$

计算出 $F(\theta)$ 后，即可按式 (4.53) 编制的积分程序，由计算机计算出被测光纤的模场直径。为避免光源与光探测器直接耦合，要选用光分路器将光源发出的光耦合至光纤和将散射的光耦合到光探测器，还应避免使用与偏振相关的器件。

② 试验装置

可变孔径法测量单模光纤模场直径的试验装置，如图 4.30 所示。该试验装置主要由光源、可变孔径器件、透镜系统、探测器等部分组成。可变孔径法试验装置中的光源、调制。注入条件、包层模剥出器、试样、探测器、放大器、数据

获取等部分的作用与远场扫描法中的相同。所不同的只是在光纤端面与透镜系统之间装有一个与光学系统光轴垂直的可变孔径转盘。转盘上开有至少 12 个不同孔径的圆孔，要求这些圆孔半径对应的远场半张角的数值孔径覆盖范围为 0.02 ~ 0.25 (对 G.653 光纤，要求覆盖范围为 0.02 ~ 0.401)。将通过转盘上每个圆孔传输的光收集起来并聚焦到探测器。

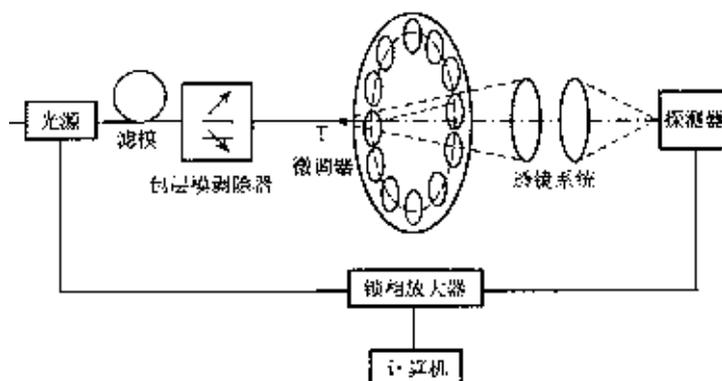


图 4.30 可变孔径法试验装置

③ 试验程序

将制备好的光纤试样插入试验装置中，借助注入光束来对准光纤光注入端。光纤输出端的对中使用一个合适的输出器件。

测量通过每个孔径传输的光功率，求出互补孔径传输函数 $F(\theta)$ ，再利用式 (4.53) 计算出被测光纤的模场直径。

(3) 近场扫描法

① 测量原理

近场扫描法是测量单模光纤模场直径的第二替代试验法。近场扫描法的测量原理是使用具有针孔的扫描光探测器或摄像机，在近场图上沿一经过模场中心的直线扫描，测量出近场光强度与分布 $F(r)$ 由式 (4.55) 计算出被测光纤的模场直径。

② 试验装置

近场扫描法测量单模光纤模场直径的试验装置，如图 4.31 所示。该试验装置主要由光源、放大光学系统、扫描探测器或摄像机等部分组成。近场扫描法试验装置中的光源、调制、注入条件、包层模剥除器、试样、探测器、放大器、数据获取部分的作用与远场扫描法中的相同。

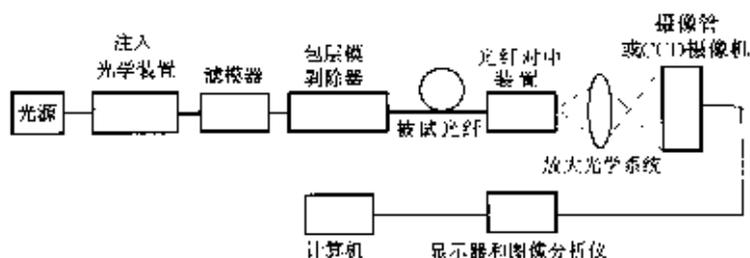


图 4.31 近场扫描法试验装置

与远场扫描法试验装置所不同的是扫描组件。用一个放大光学系统将光纤近场图像放大并聚焦到扫描探测器平面上(例如,具有针孔的扫描光探测器或带尾纤的扫描光探测器)。所选择的数值孔径和放大倍数应与所需要的空间分辨率相一致。光学系统的放大倍数是通过扫描已知长度的光纤试样来校准的。

③ 试验程序

用注入光束来对准光纤的注入端,用合适的输出器件来对准光纤输出端。试验程序为:用放大光学系统来放大光纤近场图像,并将其聚焦至探测器平面上。为减小散射图像扫描造成的尺寸误差,应以最大精度来完成聚焦,用扫描得到的近端光强度分布 $F(r)$,按式(4.55)计算出被测光纤的模场直径。

(4) 双向后向散射差法

① 测量原理

双向后向散射差法是测量单模光纤模场直径的第三替代试验法。双向后向散射差法的测量原理是由两个方向的后向散射通过一根已知模场直径的盲区光纤接头所产生的双向后向散射差来确定被测光纤的模场直径:

$$w_s = w_d 10^{\frac{g(L_d - L_s) + f}{20}} \quad (4.57)$$

式中: w_d —盲区光纤的模场直径;

w_s —被测光纤的模场直径;

L_d —由盲区光纤测量时通过接头的后向散射的变化(dB);

L_s —由被测光纤测量时通过接头的后向散射的变化(dB);

g —与波长和光纤结构有相关的修正因子;

f —与波长和光纤结构有关的修正因子。

② 试验装置

双向后向散射差法测量光纤模场直径所使用的试验装置,如图 4.32 所示。试验装置中的光时域反射计(OTDR)的组成与工作原理如第 6 章 2 节 1 中所述的 OTDR 的组成和工作原理相同。图 4.32 给出的是一个采用光开关的试验装置的示意图。这样的试验装置是经选定的。

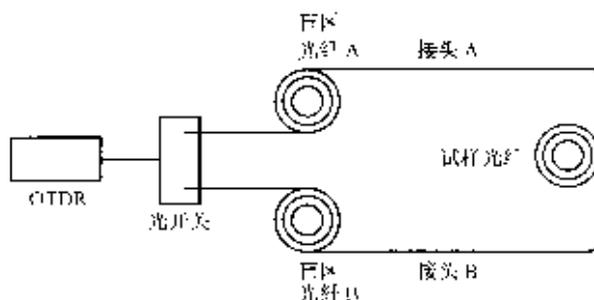


图 4.32 选定的试验装置双向后向散射法

光时域反射计 (OTDR) 光源波长在 2nm 内。在 $1310\sim 1550\text{nm}$ 范围内测量时， 2nm 的移动会引起 $0.02\ \mu\text{m}$ 的误差。

盲区光纤应足以防止由接头或与被测光纤的对耦接点造成的盲区。采用任一方法，基准法或第一替代法或第二替代法测量 $1310\ \text{nm}$ 和 1550nm 盲区光纤的模场直径。盲区光纤的典型结构应与被测光纤相同。

在整个测量过程中，接头或对接耦合点应保持稳定，以求不影响测量结果。当采用对接耦合点时，建议选用折射率匹配液来减小反射。

③ 试验程序

双向后向散射差法试验程序分为两个步骤。首先，在已知修正因子 g 和 f 的情况下求出光纤和波长程序，其次，在给定波长下，验证光纤类型和结构程序。定量程序包括 g 和 f 修正因子的精确计算，OTDR 波长偏离标准波长允许修正 g 和 f 。在 g 和 f 未知，而且精确的确定做不到时，我们假定 g 和 f 的标准值为 1 和 0。

A. 在给定波长下的光纤测量

微调光纤使光源由盲区光纤 A 注入试样光纤（由 OTDR 经过接头 A 进入试样光纤，如图 4.32 所示）。

测量通过接头的后向散射的变化（如图 4.32 所示的接头 A），避免任何反射，将后向散射的变化值记录为 L_d 。

微调光纤使光源由试样光纤注入盲区光纤 A（由 OTDR 经过接头 B 进入试样光纤，再经过图 4.32 所示的接头 A）。

测量通过接头的后向散射的变化（如图 4.32 所示的接头 A），避免任何反射，记录后向散射变化值为 L_s 。

按照式 (4.57) 计算被测光纤的模场直径。

B. 光纤类型、结构和波长的判定

选择一个光纤，对其类型和结构进行测量。测量方法既可采用基准试验法也可采用第一替代试验法和第二替代试验法，在所需的波长下测量光纤的模场直径 W_s ，光纤的模场直径范围代表着试样的光纤类型和结构。

由给定波长下的光纤测量程序来确定经过接头的后向散射的变化 L_d 、 L_s ，计算每种光纤的 $20\log_{10}\left(\frac{W_s}{W_d}\right)$ ，做出 $20\log_{10}\left(\frac{W_s}{W_d}\right)$ 与 (L_d-L_s) 的线性回归线来确定 g

(斜率) 和 f (截距)。选择第二种光纤试样来确定 g 和 f 。光纤模场直径的测量方法仍可用基准试验法或第一替代试验法或第二替代试验法。

完成给定波长下的光纤测量程序，再用回归线求得 g 和 f 来确定模场直径 W_s 。找出与用基准试验法和第一替代试验法或第二替代试验法的测得值的差别，如果要说明等效性要计算平均差 (bias) 标准偏差。

通过计算等效性大小 B 可以求得可接受的测量等效性。

$$B = |bias| + 2\sigma_d / \sqrt{n} \quad (4.58)$$

式中： n 为样本大小。 B 的典型上限为 $0.1 \mu\text{m}$ 。如果 B 超过上限，需要调整试验程序，例如建议改善接头或对耦接头。

六、有效面积

1. 定义

(1) 非线性效应

当前人们通过采用光纤放大器增大光纤中的光传输功率的方法来实现远距离传输。但是，因光纤芯面积上的光信号功率过大而使传输光纤出现非线性效应。因此，光纤的非线性效应已在大容量和远距离的传输系统中受到高度重视。光纤的非线性效应通常分为散射效应（受激布里渊散射和受激拉曼散射）或与 Kerr 效应相关的效应，即光强与折射有关（自相位调制、交叉相位调制、调制不稳定、孤子形成和四波混频）。影响这些非线性效应程度的因素包括：光纤色散特性、单模、光纤的有效面积、波分复用系统中的信道数、信道间距大小。整个无中继系统距离、光纤特性的纵向均匀性、信号光强和光源谱线宽度。

(1) 有效面积 A_{eff}

单模光纤有效面积是一个影响光纤系统（特别是远距离光放大系统）传输质量与光纤非线性效应直接相关的参数。有效面积的定义如下：

$$A_{\text{eff}} = \frac{2\pi \left[\int_0^{\infty} I(r) r dr \right]^2}{\int_0^{\infty} I(r)^2 r dr} \quad (4.59)$$

式中： $I(r)$ 为半径 r 的光纤基模场强度（场幅值的平方）分布。式 (4.59) 积分是对光纤的整个横截面积。例如，如果我们做一个高斯近似则得：

$$I(r) = \exp\left(\frac{-2r^2}{w_0^2}\right) \quad (4.60)$$

式中： $2w_0$ 为模场直径，那么式 (4.59) 分开积分且得到：

$$A_{eff} = \pi w_0^2 \quad (4.61)$$

高斯近似对波长在 LP_{11} 附近的 G. 652 光纤和 G. 654 光纤是精确的。对更长波长的 G. 652 光纤、G. 654 光纤和 G. 653 光纤的有效面积不能由式 (4.61) 精确地估算出 A_{eff} 和 w_0 之间的经验关系式更通用形式为：

$$A_{eff} = k\pi w_0^2 \quad (4.62)$$

式中： k 是一个修正系数。对不同光纤，在不同波长 k 值取值不同。

(2) 修正系数 k

式 (4.62) 的修正系数 k 与波长和光纤参数有关，例如：折射率分布、模场直径和零色散波长有关。经过实验证实，通常波长增大，G. 652、G. 653、G. 655 光纤模场直径和有效面积都会增大。G. 652 光纤、G. 653 光纤和 G. 654 光纤的修正系数 k 的范围，参见表 4.1。

表 4.1 几种光纤的修正系数 k

光纤类型	工 作 波 长	
	~ 1310nm	~ 1550nm
G. 652	0.970 ~ 0.980*	0.960 ~ 0.970
G. 654	0.970 ~ 0.980	0.975 ~ 0.985*
G. 653	0.940 ~ 0.950	0.950 ~ 0.960*
G. 655		1.020 ~ 1.160

*最佳波长范围

2. 测量方法

可借助单模光纤模场直径的测量方法来确定单模光纤（特别是 G. 655 光纤）的有效面积。ITU-T G. 65 (2000) 推荐的单模光纤有效面积测量方法有远场扫描法和可变孔径法。下面介绍远场扫描法和可变孔径法的测量原理。试验装置和试验程序。

(1) 远场扫描法

① 测量原理

单模光纤的有效面积可用远场扫描法来测量，其测量原理是将光纤注入端与注入光束对准，光纤输出端与合适的输出装置对准，通过变换扫描角度测量远场辐射光功率，再利用合适的数值积分法计算出近场光强，求出单模光纤的有效面积。

② 试验装置

远场扫描法测量单模光纤有效面积的典型试验装置，如图 4.33 所示。有关

试验装置中光源、调制、注入条件、包层剥除器、试样、扫描装置、放大器 and 数据处理等内容, 请读者参阅本书 4.2.5 节单模光纤模场直径的远场扫描法试验装置的内容。

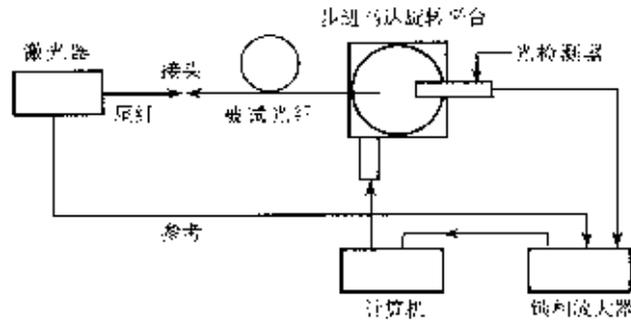


图 4.33 远场扫描法试验装置

③ 试验程序

注入光束应与光纤注入端对准, 光纤的输出端应与合适的输出装置对准。由测得的远场辐射光功率计算出单模光纤的有效面积。

通过扫描一定长度的试样 (其尺寸精度已知) 来校正放大用光学器件的放大倍数, 并记录这个光放大倍数。叠加远场辐射光功率数据, 让 $P(\theta_i)$ 测得的光功率, 其为变换角度 I 的角位置 θ_i 函数 $0 \leq \theta_i \leq \theta_{\max}$ 的叠加的光功率曲线函数 $P_f(\theta_i)$ 为:

$$P_f(\theta_i) = \frac{P(\theta_i) + P(-\theta_i)}{2} \quad (4.63)$$

计算近场光强图形, 用一合适的数值积分法来算出式 (4.59) 的积分。如下是一例子。任何其他积分法至少应是精确的。计算半径为 r 的光强近场分布图, 求得的光强分布在最大半径的光强大比半径为零处的光强的 0.01% 还要小。

$$I(r_j) = \left[\sum_{j=0}^n P_f^2(\theta_i) J_0 \left(\frac{2\pi r_j \sin(\theta_i)}{\lambda} \right) \sin(2\theta_i) \Delta\theta \right]^2 \quad (4.64)$$

式中: $\Delta\theta = \theta_i - \theta_0$

对式 (4.55) 进行积分, 用一合适的数值积分法对式 (4.60) 进行积分。下列公式为一例子。任何其他积分法也应是精确的。

单模光纤的有效面积可由下式求得:

$$A_{\text{eff}} = \frac{2\pi T}{B} \quad (4.65)$$

式中: $B = \sum_0^m I^2(\gamma) \gamma \Delta\gamma, T = \left[\sum_{j=0}^m I(r_j) r_j \Delta r \right]^2, \Delta\gamma = \gamma_1 - \gamma_0$

m 为测得的位置数。

图 4.34 是由测得的远场光功率数据绘制的光强分布图。

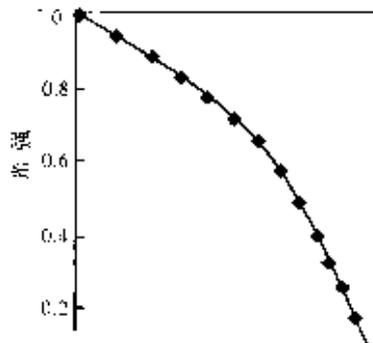


图 4.34 远场法测得的光功率分布

(2) 可变孔径法

① 测量原理

单模光纤的有效面积可用远场测量技术中的可变孔径法测量,其测量原理是通过测量已知数值孔径的光纤对应的远场角 θ 总的归一化功率 $f(\theta)$,由四次方函数拟合成远场孔径数据,再由半径为 r 的近场光功率分布 $I(r)$ 求出单模光纤的有效面积。

② 试验装置

可变孔径法测量单模光纤的有效面积的试验装置,如图 4.35 所示。试验装置中的光源、调制、注入条件、包层模剥除器、试样探测器、放大器和数据处理等内容,请读者参阅本书第 6 章第 2 节 5 中单模光纤模场直径测量的可变孔径法试验装置内容。孔径装置至少包含 12 个数值孔径扫描半角。所选用的数值孔径为 0.02 ~ 0.25。通过孔径传输出光纤的光被收集聚焦到探测器。收集光的光学装置的数值孔径应大一些,以免影响到测量结果。

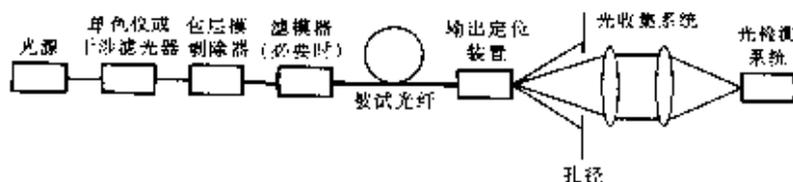


图 4.35 可变孔径法试验装置

输出可变孔径系统由一个可变孔径圆传输设备(例如,一个孔径盘)组成。该系统放置在离开光纤端面至少为 $100w_0/\lambda$ 的距离为 D 处。它用来改变由光纤输出图形获得的光功率。所用的典型孔径为 12 至 20,且其位置距离光纤端面大约

20 ~ 50mm。试验装置最大数值孔径应为 0.40。应该选用与光纤端面角不敏感的图形定位方法。作为试验装置的一部分（如图 4.35 所示），仔细地测量和记录下光纤输出端位置与孔径盘面之间的距离 D 和每个孔径的直径 X_i 。确定孔径盘中每个孔径对应的半角。并为进一步计算需要记录下这些 θ_i （为增大孔径尺寸 $i=1-n$ ）值。这些 θ_i 值与试验波长无关。

(3) 试验程序

用注入光束对准光纤注入端面，光纤输出端面与合适的输出装置对准。单模光纤的有效面积 A_{eff} 由式 (4.63) ~ (4.67) 求得。

试验装置校正通过扫描用已知具有合适精度的装置来测量放大装置的放大倍数。单模光纤的有效面积的计算是用可变孔径法测量角 θ ，如图 4.35 所示。光纤对应的远场，即通过已知孔径总的归一化光功率 $f(\theta)$ 。这些光功率值等效归一化远场光功率分布 $F(\theta)$ 的积分：

$$\int(\theta) = \int_0^{\infty} F^2(\theta) \sin(\theta) d\theta \quad (4.66)$$

四次方函数拟合成远场孔径数据的公式如下：

$$\int(\theta) = A\theta^4 + B\theta^3 + C\theta^2 + D\theta + E \quad (4.67)$$

单模光纤的有效面积 A_{eff} 可由作为半径 r 的函数的近场光功率分布 $I(r)$ 求得。为进行计算必须对积分的光功率数据 $f(\theta)$ 进行一次微分求出远场光功率分布 $F(\theta)$ ：

$$F^2(\theta) = \frac{df(\theta)}{d(\theta)} \cdot \frac{1}{\sin\theta} \quad (4.68)$$

由远场光功率分布 $F(\theta)$ ，用逆 Hanke1 变换可将计算的近场光功率分布 $I(r)$ 表示为半径 r 的函数：

$$I(r) = \left[\int_0^{\infty} \sqrt{F^2(\theta)} \cdot J_0\left(\frac{2\pi r}{\lambda}\right) \sin 2\theta d\theta \right] \quad (4.69)$$

那么，有效面积 A_{eff} 可用公式 (4.70) 由近场光功率分布 $I(r)$ 求得：

$$A_{eff} = 2\pi \cdot \frac{\left[\int_0^{\infty} I(r) \cdot r \cdot dr \right]^2}{\int_0^{\infty} I(r)^2 \cdot r dr} \quad (4.70)$$

七、数值孔径

1. 定义

数值孔径是多模光纤的一个重要光学参数，它表征多模光纤集光能力大小及与光源耦合难易程度，同时对连接损耗、微弯损耗、宏弯损耗、衰减温度特性和传输带宽等都有影响。通常，根据折射率分布测量方法将数值孔径定义如下：

(1) 最大理论数值孔径 NA_{th}

根据光纤折射率分布得出的最大理论数值孔径定义为：

$$NA_{th} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \approx n_1 \sqrt{2\Delta} \quad (4.71)$$

式中： n_1 —光纤芯的最大折射率；

n_2 —包层的折射率；

Δ —芯包相对折射率差；

$$\Delta = (n_1 - n_2) / n_1 \leq 1$$

NA_{th} 表述的物理意义是光纤收集光线的的能力。

(2) 远场数值孔径 NA_{ff}

远场数值孔径是通过测量光纤远场分布确定的。远场数值孔径 NA_{ff} 的定义为光纤远场辐射图上光强下降到最大值 5% 的半角 (θ_s) 的正弦值。

$$NA_{ff} = \sin \theta_s \quad (4.72)$$

(3) NA_{th} 与 NA_{ff} 之间的关系

NA_{ff} 和 NA_{th} 之间的关系与测量波长有关。测量远场光强分布大多在 850nm 波长上进行，而测量折射率分布通常则在 540nm 或 633nm 波长上进行。对于这些波长， NA_{ff} 和 NA_{th} 之间的关系如下：

$$NA_{ff} = k NA_{th} \quad (4.73)$$

式中： k —修正系数，取值为 0.95 和 0.96，它们分别对应的测量波长为 540nm 和 633nm。

通常，我们应将 850nm 波长上测得的 NA_{ff} 作为光纤数值孔径。光纤的数值孔径可直接通过测量 850nm 波长上的远场光强分布获得，或间接由 NA_{th} 来获得。

2. 测量方法

多模光纤的数值孔径的测量方法有测量短段光纤远场辐射图（远场光强分布法）和测量光纤折射率分布（折射近场法）两种。

有关远场光强分布法和折射近场法的测量原理、试验装置和试验程序等内容如下所述。

(1) 远场光强分布法

① 测量原理

远场光强分布法是测量多模光纤数值孔径的基准试验法。远场光强分布法测量原理是先测量出光纤远场角辐射光强分布，再利用远场分布法的 NA_{ff} 定义式 (4.72) 计算出光纤的数值孔径。

② 试验装置

多模光纤数值孔径的远场光强分布法的试验装置，如图 4.36 所示。

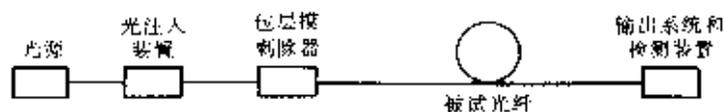


图 4.36 远场光强分布法试验装置

A. 光源

光源为强度可调的非相干光源，它能在光纤试样端面上产生基本恒定的辐射（光强变化 $<10\%$ ）面。在整个测量过程中，光源的强度、波长和位置应保持稳定。光源中心波长为 $850 \pm 25\text{nm}$ 。

B. 光注入装置

为稳定和重复定位而不使光纤明显变形，应配置一个光纤试样输入固定端装置。为使光纤试样输入面与注入光束对中，应配置一个合适的装置来达到对中目的。同时还应提供一种对光纤试样端面是否与注入光束对中的检验方法。

C. 包层模剥除器

为消除包层中传输的光功率，应选用一个合适的包层模剥除器担当此任。

D. 输出系统和检测装置

通常，可采用远场辐射图的角扫描和空间场扫描方法检测光纤试样出射远场的角辐射光强度分布。

③ 试验程序

被测光纤长度为 $2.0 \pm 0.2\text{m}$ 。所制备的试样两端面应清洁、平整光滑，且与光纤轴垂直，端面角 $<2^\circ$ 。为避免弯曲产生模转换和模辐射，光纤试样要放直。

试验前应将试样两端置于对中固定装置上。试样输入端应大致位于恒定辐射光斑聚焦像的中心。将光源调整到试验要求的波长和光谱线宽。扫描远场辐射图，并记录作为角位置函数的光强。

从远场光辐射图上找出光强最大值 5% 处的点，将这两点对应的半角作为 θ_5 记录下来，再用式(4.72)计算出远场数值孔径 NA_{ff} ，即光纤的有效数值孔径。

(2) 折射近场法

折射近场法是用来测量光纤最大理论数值孔径的方法。折射近场法是替代试验法。折射近场法的测量原理是，首先用折射近场法测出光纤的折射率分布曲线，然后从折射率分布曲线上求出纤芯中最大折射率 n_1 和包层折射率 n_2 ，再根据式(4.71)计算出光纤的最大理论数值孔径 NH_{th} 。

有关折射近场法的试验装置，试验程序等内容，请读者参阅本书2.2.2节中，有关光纤折射率分布测量的折射近场法的相关内容。

八、光学连续性

1. 定义

光纤的光学连续性并不作为一促光纤性能的测量方法，而仅是对光纤的连续性或断裂的差异进行检测。例如，一段短光纤在拉伸、曲挠、弯曲和扭转试验期

间受到机械损伤时，由于光纤长度太短（即分辨率受限制），在采用后散射仪不合适的情况下，光学连续性的检测就显得十分必要。

光纤段光学连续性的定义是表征光纤段传导光功率的能力。光学连续性可用在光纤一端注入光时，另一端输出的光功率来表示。

光纤光学不连续是指在特定的注入和检测条件下，光纤输出端实际测得的光功率比注入光纤的光功率小一个约定值时，则认为这根光纤光学不连续。该约定值应由用户和厂商商定。

2. 测量方法

光纤光学连续性的检测采用的方法是传输或辐射光功率法。有关传输功辐射光功率法的测量原理、试验装置和试验程序等内容，如下所述。

(1) 测量原理

传输或辐射光功率法的测量原理是借助一个光功率计来指出一根光纤光学连续或产生严重的衰减增大。

(2) 试验装置

传输或辐射光功率法测量光纤光学连续与否的试验装置，如图 4.37 所示，试验装置主要光发射单元和光接收单元两部分组成。

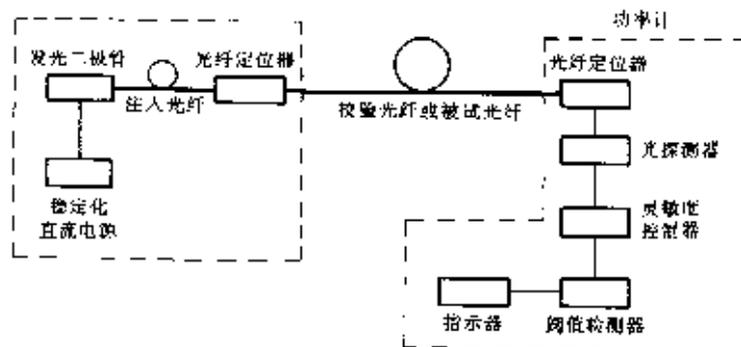


图 4.37 传输或辐射光功率法试验装置

① 光源

光源是一个由 LD 或 LED 组成的大发光面积的注入光纤光学终端器件。为方便起见，它也可与一根注入光纤耦合。为了减少注入光纤光学终端器件一侧的损耗变化，当采用注入光纤时，注入光纤应是阶跃型折射率分布光纤。光纤纤芯直径要大于被测光纤芯直径。

② 光探测器

采用与光源相匹配的光探测器，例如光电二极管。它与由灵敏度控制器调节的阈值探测器和指示器相连。光探测器的光敏面应有较大的面积。

③ 光纤定位器

光纤定位器用来对注入光纤光学终端和被测光纤光学终端的快速定位。

④ 校验光纤

连接发射器和接收器的校验光纤用来获得零校准点。

(3) 试验程序

装置调节时,采用一根已知是光学连续的短校验光纤来检验试验装置的工作情况。当采用图 4.37 所示试验装置时,调节灵敏度控制器,使接收光功率刚好超过阈值探测器的阈值,并且指示器工作。

初始测量时,将用被测光纤取代检验光纤。在确定的灵敏度值的基础上,按对被测光纤预期的衰减量增加灵敏度保证指示器工作。指示器工作表明光纤是光学连续的。

如指示器不工作就增加灵敏度,直至指示器工作。计算使指示器工作所需要的以 dB 表示的灵敏度增量。如果衰减增量(或灵敏度增量)超过约定值,则认为光纤断裂。

光纤受到机械损伤后测量,仅对受机械损伤前是光学连续的光纤进行。使光纤能经受所要求的机械损伤作用。如有必要,则更换试验装置中的光纤。

如指示器不工作,应增加灵敏度,直至它工作。计算相对于初始测量确定的灵敏度值的灵敏度增量,如因机械损伤试验导致衰减增量(或灵敏度增量)超过约定值,则认为光纤断裂。

九、微弯敏感性

1. 定义

光纤是柔软的可弯曲的,如果弯曲的曲率半径太小,将使光的传播途径改变,使光从纤芯渗透到包层,甚至有可能穿过包层向外泄漏掉。因此当光纤弯曲时,例如常发生在成缆、现场敷设(管道转弯)、光缆接头等场合下引起弯曲损耗。

微弯是一些随机的曲率半径可以与光纤的横截面尺寸相比拟的畸变,常发生在套塑、成缆过程,光纤(或光缆)的周围温度发生变化等场合下。所以,微弯损耗是光纤随机畸变而产生的高次模与辐射之间的模耦合所引起的光功率损失。其微弯损耗大小由下式求出:

$$\alpha_m = N \langle h^2 \rangle \frac{\alpha^4}{b^6 \Delta^3} \left(\frac{E}{E_f} \right)^{3/2} \quad (4.74)$$

式中: N — 随机微弯的个数;

h — 微弯凸起的高度;

$\langle \rangle$ — 表示统计平均符号;

E — 预涂覆层材料的杨氏模量;

E_f — 光纤的杨氏模量;

α — 纤芯半径;

b — 光纤外半径;

Δ — 光纤的相对折射差。

微弯敏感性则指的是光纤对微弯损耗的相对敏感性。

2. 测量方法

单模光纤和多模光纤微弯损耗的敏感性的测量方法有可膨胀圆筒法、固定直径圆筒法和金属格网法三种。这三种测量方法的试验结果只能进行定性比较,它通常只用在光纤的一般评估。

(1) 可膨胀圆筒法

① 测量原理

可膨胀圆筒法的测量原理是由一个在施加的线性压力范围内测量单模光纤由于微弯效应产生的损耗增加,其损耗增加量是施加在光纤上一线性压力的函数。所测得的结果反映出单模光纤微弯敏感性。

② 试验装置

可膨胀圆筒法试验装置是由一个可膨胀的圆筒组成。其直径能连续改变。为了避免宏弯效应,要求包括膨胀部分的任何局部最小弯曲直径小于 200mm。圆筒表面衬垫是具有一定粗糙度的特定材料(例如粘覆颗粒度为 $40\mu\text{m}$ Al_2O_3 的砂纸的薄膜— $40\mu\text{m}$ 级矿质 Al_2O_3)。

圆筒膨胀时,应采用本章单模光纤色散测量方法中的相移法试验装置,测量光纤伸长率。衰减测定应采用衰减测量中截断法或后向散射法。

③ 试验程序

将被测光纤无张力地小心地在圆筒上绕一层,卷绕时应避免光纤任何交叉或重叠,并使光纤固定以防相对滑动。试验中应记录圆筒膨胀时衰减系数的变化和相位的变化。

光纤伸长率 ε 可由下式求得:

$$\varepsilon = \frac{\Delta\theta}{fL} V \quad (4.75)$$

式中: $\Delta\theta$ —相移($^\circ$);

f —调制频率(Hz);

L —试样长度(km);

V —与光弹系数 k 、真空中光速 c 和有效群折射率 N_{ef} 有关的常数。

$$V = \frac{kc}{360N_{ef}} \quad (4.76)$$

对非色散位移单模光纤(常规单模光纤), V 的典型值为 $726(\text{km/s})(^\circ)$ 。由此可计算线性压力:

$$P = T/R = EA\varepsilon/R \quad (4.77)$$

式中: T —施加于光纤上的张力(N);

R —静止条件下可膨胀圆筒半径(mm);

E—光纤杨氏模量 (N/mm)；

A—光纤（芯与包层构成的玻璃部分）横截面积 (mm²)。

作出衰减系数 (dB/km) 变化与线性压力 P (N/mm) 或伸长率 ε (%) 的函数关系曲线。由所获得的点通过内插得到一条经过坐标原点的直线，这条直线的斜率是被测光纤的微弯敏感性。微弯敏感性的单位为 (dB/km) / % 或 (dB/km) / (N/mm)。

(2) 固定直径圆筒法

① 测量原理

固定直径圆筒法的测量原理是在给光纤施加固定线性压力时，由微弯效应致使被测光纤产生的附加损耗。

② 试验装置

固定直径圆筒法试验装置由固定直径的圆筒组成。为了避免宏弯效应，要求固定圆筒最小直径为 200mm。圆筒表面衬垫是具有一定粗糙度的特定材料（例如粘覆颗粒度为 40μm Al₂O₃ 砂纸的薄膜）。在圆筒覆盖层表面上至少能绕 400mm 被测光纤。

衰减测量应采用衰减测量中截断法或后向散射法。

③ 试验程序

应用 3N（暂定值）的卷绕力将被试光纤单层绕在圆筒上，再测量总衰减系数。为了得到由微弯敏感性引起的衰减增加，应用被测光纤固有的衰减系数对测得的总衰减系数进行修正。在大卷绕力情况下，测得的总衰减主要是微弯损耗。

微弯敏感性可由下式求出：

$$\text{微弯敏感性} = \frac{\alpha R}{T} = \frac{\alpha}{P} \quad (\text{dB/km}) (\text{N/mm}) \quad (4.78)$$

式中：α—由微弯引起的衰减增加 (dB/km)；

P—线性压力 (N/mm)；

R—固定圆筒半径 (mm)；

T—施加于光纤上的卷绕张力 (N)。

可采用不同的卷绕张力按程序进行多次测量。

(3) 金属网格法

① 测量原理

金属网格法的测量原理是利用金属网格使光纤产生微弯，从而确定光纤微弯损耗的相对敏感性。

② 试验装置

金属网格法试验装置的主要组成部分有：光源、探测器、微弯引入装置等。

A. 光源

光源的 FWHM 谱宽应不大于 10nm（或在光纤产品规范中规定）在整个测量期间，光源波长、强度和位置应保持稳定，并能在某一波长范围内工作。

B. 探测器

应采用谱响应与光源相匹配的光电二极管探测器，光探测器的系统响应应与所采用的调制技术相匹配，并且在测量波长范围内是线性的。为改善接收机信噪比，应对光源进行调制。

C. 滤模器

为防止光纤中有高次模传输，应采用滤模器，可在光纤上打一直径为 60mm 的单圈作为滤模器。

D. 微弯引入设备

产生微弯损耗的典型设备，如图 4.38 所示。金属基座平台起稳定作用，其表面光滑。两个定位柱固定在基座平台上。

一薄片硬化橡胶被固定在基座平台上，它相对于定位柱不能移动。橡胶片上面作了一个标记，该标记是一个直径为 98.5mm 的圆。将橡胶片的一部分切割掉以防止光纤交叉，这使被试光纤长度减少了大约 8mm。橡胶片表面应平坦，上面不能刻任何形式的槽。

金属网格上有二个孔，以便能用基座平台上的定位柱对金属网格进行重复的精确定位。

标称质量为 1kg 的顶板上有两个孔，使得它能滑进基座平台上的定位柱。一组 5 块负荷（例如 5 块 \times 1kg）提供附加负荷以引起附加微弯损耗。

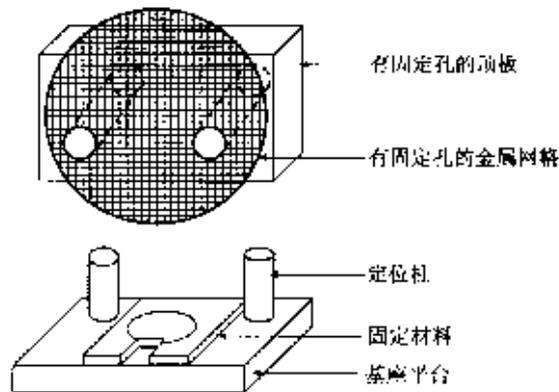


图 4.38 微弯引入设备示意图（金属网格法）

试验条件：

- a. 波长范围：1200 ~ 1600nm；
- b. 光源谱宽：不大于 10nm；
- c. 波长步进量：10nm；
- d. 1 块负荷重量：1kg；
- e. 金属网格特征：70 根丝编成；
- f. 采样数：5 ~ 10。

③ 试验程序

将光纤绕成一圈圈的圆环放置在橡胶片上。必要时用几片胶带(不超过三片)将光纤固定。将金属网安放在定位柱上,小心地把顶板放下,下推金属网格使之压在光纤上。在规定的波长范围内记录功率读数。

将规定的负荷块压在顶板上,并在规定波长范围内记录功率读数。依次将其他的负荷块加在顶板上,并在规定波长范围内记录功率读数。

计算出平均损耗增量,用 $(\text{dB/m}) / (\text{kg/m})$ 表示。该平均损耗增量是在规定波长范围内波长的函数。

第五章 光纤机械性能

第一节 光纤机械性能测试目的

当光纤在成缆过程中和用于实际环境中时,必须经受住一定的机械应力和化学环境的侵蚀;在光缆施工过程中,光纤需要量熔融连接,光纤涂敷层的可剥离后裸纤的翘曲度都会影响光纤的熔接难易和损耗大小,这些都属于光纤机械性能和操作性能的范畴。石英光纤必须具有足够的强度来经受机械环境,例如光纤的二次被覆,以及光缆敷设和运行期间受到的张力、宏弯和微弯。在通常的使用条件下,光纤都会受到张力(如在光缆中)、均匀弯曲(如在圆筒上)或平行表面的两点弯曲(如在熔接情况中)。在所有这些机械环境中,光纤经受了环境构成所特有的应力。最普通的机械环境是单轴向张力。石英光纤是一种脆性材料,在施加的应力下经历持续的变形后会断裂成两段或几段。由于光纤断裂会导致通信线路中断,故光纤的材料强度和可靠性是人们最关心的问题。对于系统上的光纤而言,系统失效的唯一主要原因就是光缆失效,固有因素引起的失效很少,多半原因是由于火灾和直埋光缆附近的挖掘引起突然断裂一类的外部因素。随着光纤制造技术的不断提高,目前所用光纤的筛选强度都在 0.69GPa 以上,内在的机械失效的概率很低,尽管如此,由于修理和更换光纤的成本很高,故相关的经济风险便不可小视,这些风险促使人们努力把运行中的内在机械失效的概率减小到最低,因而提高光纤产品的长期机械可靠性是主要的课题。

实际上,光纤的机械强度由表面存在的裂纹和杂质决定,涂敷层也起着至关重要的作用。涂敷层的粘附力越强,对裂纹的保护作用就越明显,光纤的强度就越高。另一方面,在光缆的连接中,需要剥除光纤的涂敷层进行熔接,在光纤光缆的测试中,需要剥除光纤的涂敷层制作端面,也就是说,光纤涂敷层应具有可剥性。所以涂敷层的粘附力不宜小也不宜大,按国家标准规定,涂敷层的剥离力

在 1.3~8.9N 之间。

当剥去涂敷层后，一根未支撑的光纤有一个自然弯曲的趋势，即翘曲性能。例如，一根从 V 形槽的端面出来的悬空光纤可以向上、向下或者向左右弯曲。虽然翘曲对连接器、机械连接或使用有源校准的熔融连接没有坏的影响，但翘曲可在光纤是无源熔融连接时或许多光纤同时熔接(光纤带的批量熔接)时产生偏离。

为了使得光纤能在实际的通信线路上使用，它应具有足够的机械强度和便利的操作性能，以便于成缆和敷设，而且可在恶劣的环境条件下不会因疲劳而断裂，以保证光纤足够的使用寿命。我们必须弄清光纤的断裂机理、机械强度试验方法、表征光纤强度的各参数的物理意义和光纤使用寿命的计算方法。

第二节 测量方法

用来表征具有预涂覆层或缓冲层光纤的机械强度、操作性能、物理缺陷、可剥离性、应力腐蚀敏感性参数、翘曲性能优劣的测量方法有：筛选试验、光纤抗拉强度、磨损、目视、静态和动态疲劳、侧视显微法和激光束散射法。下面将分别介绍这些试验方法的测量原理、试验装置和试验程序。

一、光纤强度

(1) 裂纹及断裂

光纤制造中石英玻璃的理论强度是由 (SiO_2) 分子之间的键结合力所决定的。然后，石英玻璃光纤中玻璃基体存在的微小不均匀性、高温熔融骤冷拉丝使表面形成应力分布不匀及环境尘埃、机械损伤等致使光纤产生微裂纹。特别应指出的是光纤强度既与光纤表面微裂纹有关，又与光纤纵向分布的微裂纹数量、大小和分布有关。

借助脆性材料断裂理论可以提示光纤表面微裂纹是如何导致光纤断裂的原因。根据 Griffith 的脆性材料断裂理论，假定光纤表面的微裂纹的裂口形状为 U 字形。外界作用压力将集中在 U 字形裂口的顶端，其上的应力可用弹性理论计算出来。如图 5.1 所示的一个 U 字形裂纹，且所加应力垂直于裂纹。如外加应力为 S ，裂纹尖端有应力 σ 可用下式计算：

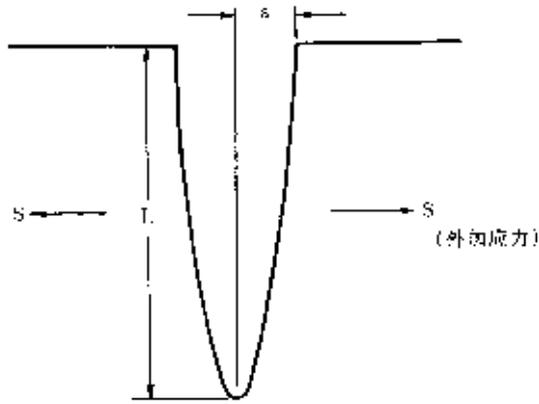


图 5.1 U 字形裂纹

$$\sigma = S \left(1 + \frac{2L}{\alpha} \right) \quad (5.1)$$

式中：L 为裂纹长度， α 为裂纹宽度的一半。如果裂纹尖端的曲率半径 $\rho = \alpha / L$ ，并假设 $L \geq \alpha$ ，则 σ 为：

$$\sigma = 2S \left(\frac{L}{e} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (5.2)$$

断裂应力 σ 与裂纹长度平方根成正比。又由 Griffith 断裂理论中应力一倍移关系得知断裂应力 σ 与裂纹长度 L 的关系为：

$$\sigma = \left(\frac{2Er}{\pi L} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (5.3)$$

式中：E 是杨氏模量，r 为表面能。用裂纹尖端的应力场表示应力强度因子 K 则有：

$$K_1 = \sigma \sqrt{\pi L} \quad (5.4)$$

将式 (5.3) 代入式 (5.4)，可得到断裂条件为：

$$K_{IC} = \sqrt{2Er} \quad (5.5)$$

K_{IC} 是应力强度因子的临界值，称为断裂韧度。当裂纹应力强度因子 K_1 增加到 K_{IC} 时，光纤上的微裂纹将会生长、扩展直至发生断裂。断裂力学正是研究有关光纤微裂纹生长规律的。

若已知断裂韧度 K_{IC} 、裂纹大小和形状，所谓光纤强度的问题就是如何消除微裂纹、怎样保护微裂纹不遭水分、尘埃和化学物质的侵蚀、设法缓解裂纹生长，预报光纤在容许的应力作用下光纤的使用寿命。

(2) 裂纹生长

假设石英玻璃光纤长度方向分布着非常小的物理缺陷或微裂纹。这样光纤的

临界断裂的发生常常是因为受到潮湿、尘埃、化学物质作用使表面强度变弱,石英玻璃光纤的包层玻璃周围涂覆着聚合物涂覆层或密封膜(例如,非晶态碳膜和施加金属涂覆层)旨在减小这些削弱光纤强度的作用。

在理想惰性环境条件下(低温、湿度为零、高真空),任何裂纹都不会生长。仅当外界施加的应力增加到 K_{IC} 时,断裂才会发生。

对非惰性环境下的光纤(如高温、潮湿、环境中水分或化学物质),任何施加应力都会使裂纹生长。由于二氧化硅键发生水解,故它被称作为应力腐蚀。

在非惰性环境下,假定裂纹生长速率 V 与应力强度因子有关的经验公式如下:

$$V = \frac{dL}{dt} = AK_I^n(t) \quad (5.6)$$

瞬间断裂的临界裂纹生长速率 V_c 则为:

$$V_c = AK_{IC}^n \quad (5.7)$$

式中: A 为与临界裂纹生长速率所处的环境有关材料尺寸参数。例如, V_c 随水分增加而增大。无量纲指数 n 为裂纹应力腐蚀敏感性参数简称 n 值。 A 和 n 都与实际环境有关。 n 值既可表明裂纹生长快慢(n 值越高,裂纹生长越慢),又可以用来计算光纤的使用寿命。

(3) 疲劳

在一定条件下,光纤表面微裂纹生长扩大至光纤断裂的过程称为光纤的疲劳。应力腐蚀(敏感性)参数 n 是一个与施加应力使裂纹生长有关的无量纲的经验参数,其大小取决于环境温度、湿度和其他环境条件。通常,人们按施加的应力方式不同,将疲劳分为静态疲劳和动态疲劳。

① 静态疲劳

静态疲劳即施加一个恒定的应力,测量其断裂时间。试验时,光纤在一个恒定外加应力 σ 的作用下,观察最弱的裂纹断裂所需的时间 $t_f(\sigma)$ 。断裂时间可由下式表示:

$$t_f(\sigma) = A_1 \sigma^{-n_s} \quad (5.8)$$

利用断裂时间与施加应力的关系简单求出 n_s , n_s 称为静态疲劳指数。 A_1 为一常数。

② 动态疲劳

动态疲劳即施加一个具有恒定速率的应力,测量加载和断裂时间。在恒定外加应力速率 σ_a 下,观察断裂时间 t_{fd} 和断裂应力 σ_f ,三者之间满足的关系为:

$$\sigma_f = \sigma_a t_{fd} \quad (5.9)$$

同时还有:

$$\sigma_f(\sigma_a) = A_2 \sigma_a^{\frac{1}{nd-1}} \quad (5.10)$$

由式 (5.10) 可求出 n_d , n_d 称为动态疲劳指数。 A_2 为一常数。

(4) 使用寿命

当光纤处在真空环境中, 由于没有水分存在, 所以不会发生应力侵蚀, 其疲劳参数 n (如 n_d 和 n_s) 为最大值, 光纤也具有最高的强度, 这时的强度就是光纤的惰性强度 S_i 。

当光纤在使用环境中具有使用寿命 t_s 与它所承受的应力 σ 和光纤的惰性强度 S_i 之间有如下关系:

$$\lg t_s = -n \lg \sigma + \lg B + (n-2) \lg S_i \quad (5.11)$$

上式中后两皆为常数, 所以当承受到的应力 σ 恒定时, 光纤的使用寿命 t_s 只与光纤的疲劳参数 n 值有关。 n 值愈大, 光纤的使用寿命 t_s 也就愈长。

2. 测量方法

(1) 筛选试验

① 测量原理

为了保证一个最低的光纤强度, 筛选试验是最好的方法。筛选试验的目的就是将整个光纤制造长度上的强度低于或等于筛选应力的点去除, 保证幸存光纤的机械可靠性。 ITU-TG. 650 规定的筛选试验的基准试验方法为纵向张力法。

纵向张力试验法测量原理是一种施加张力荷载至拉丝涂覆后的整根连续长度光纤上。被测的初始光纤会断成几段短光纤, 可以认为每段短光纤已通过筛选试验。

试验结果既可用应力 σ 表示, 也可用应变 ε 表示, 它们的关系如下:

$$\sigma = E(1 + c\varepsilon)\varepsilon \quad (5.12)$$

式中: E 为零应力下的杨氏模量, c 是一个非线性参数, 其值由试验确定 (典型值为 3~6)。由施加张力 T 计算得到的光纤张力 σ 为:

$$\sigma = \frac{(1-F)T}{\pi\alpha^2} \quad (5.13)$$

式中: 2α 为玻璃光纤的直径 (125 μm), F 是涂覆层承受的张力份额。 F 的大小由下式给出:

$$F = \frac{\sum_{j=1}^n E_j A_j}{E_g \pi \alpha^2 + \sum_{j=1}^n E_j A_j} \quad (5.14)$$

式中: n —涂覆层层数;

E_j —第 j 个涂覆层的模量;

A_j —第 j 个涂覆层的标称横截面积;

E_g —玻璃光纤的弹性模量。

② 筛选试验参数

用规定的筛选应力 σ_p 来控制幸存段光纤。筛选试验中施加应力 σ_a 的大小如图 5.2 所示。图 5.2 也显出了加载时间 t_1 、卸载时间 t_u 和筛选时间 t_d 。筛选试验施加抗张负荷的时间要尽可能地短，为了确保玻璃光纤经受住筛选应力、筛选时间又要足够的长。故光纤经受抗张负荷的筛选时间一般为 1s。

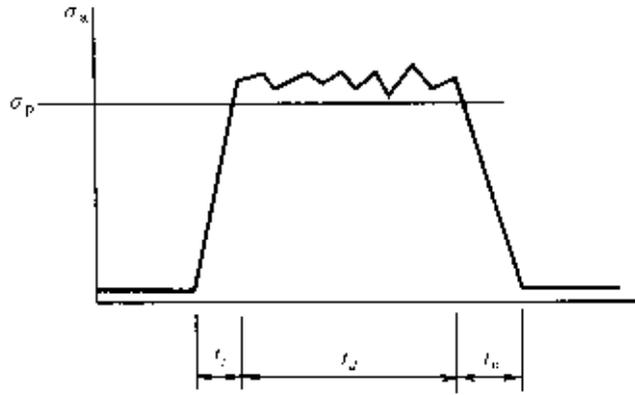


图 5.2 筛选试验中应力 σ 与时间 t 的关系

筛选试验中所施加的应力应始终超过规定的筛选应力 σ_p ，以保证光纤有一个最低强度。不过，在这里需要提醒读者的是，光纤的这个最低强度实际上是不可靠的，因为在卸掉筛选试验应力期间的动态疲劳降低了最低强度，这将涉及到一个实验上很难确定的裂纹生长参数，正是在卸掉筛选应力期间的次临界裂纹生长降低了这个最低强度。

在图 5.2 中，放丝和收丝区，光纤上维持一低应力值（典型值应不超过筛选应力的 10%）。在加载区，光纤应力由低应力倾斜上升至筛选应力，加载时间为 t_1 。筛选试验区，施加的筛选应力 σ_a 值应大于规定的筛选应力 σ_p 。卸载区，光纤应力从施加应力倾斜地降至小的应力值，卸载时间为 t_u ，卸载时间应控制在用户与厂家共同认可的最大值以下。

③ 试验装置

通过，光纤光缆生产中用来进行光纤筛选试验的试验有两种类型：制动轮筛选试验机和固定重量筛选试验机。它们的结构和工作原理，如下所述。

A. 制动轮筛选试验机

制动轮筛选试验机的结构组成，如图 5.3 所示。被筛选的光纤是以恒定的低张力从光纤盘上放出，经筛选后，光纤在恒定张力下重新被绕到收线盘上。放线和收线张力是可调的。

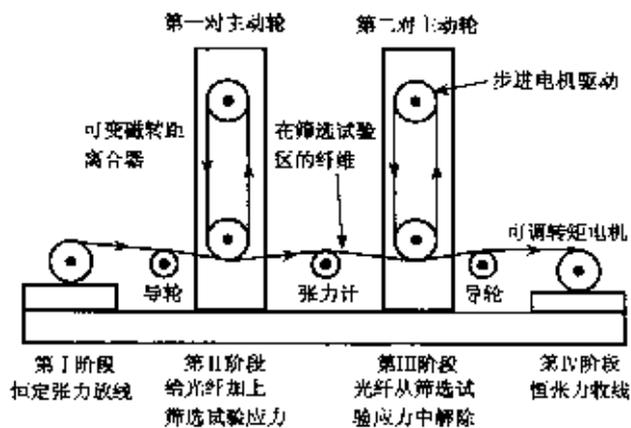


图 5.3 制动轮筛选试验机的结构组成示意图

施加到光纤上的筛选荷载是由制动轮和驱动轮之间产生的速度差造成的。制动轮和驱动轮上皮带用于防止光纤打滑。高精度张力计用来测量光纤上的荷载和控制制动轮与驱动轮之间的速度差来达到所需要的筛选荷载。筛选机施加荷载大小和操作速度快慢，可以由各自独立的装置控制。

B. 固定重量筛选试验机

固定重量筛选试验机的结构组成，如图 5.4 所示。装置中放线和收线动轮本身很轻，以求传导给光纤最小的张力。放线轮和收线轮彼此同步。放线轮和收线轮上的压紧皮带用来防止光纤滑动。它们既不会对光纤施加附加张力，也不会损伤光纤涂覆层。

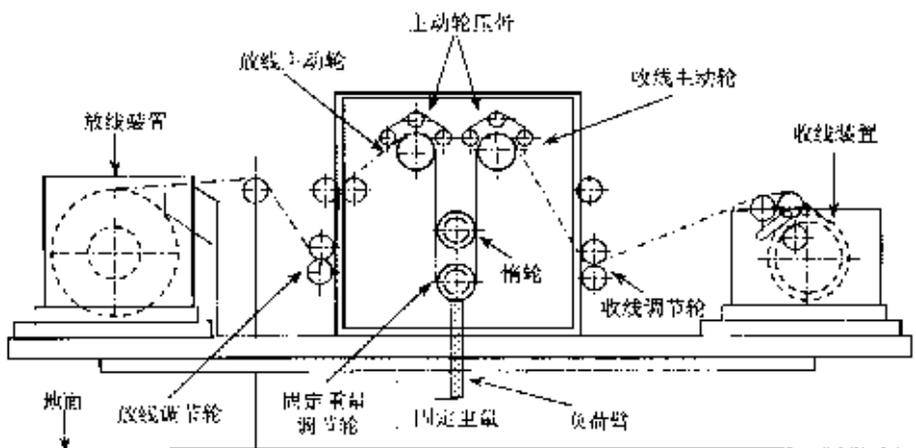


图 5.4 固定重量筛选试验机的结构组成示意图

荷载臂和一个盘子上的固定重物被安装到一个固定重物轮的轴上来向光纤提供筛选应力。当需要增加光纤在筛选试验区的长度时，可利用附加的惰轮来实现。图 5.5 是一种利用惰轮增加光纤受试长度的方法。

④ 试验程序

试样应是一根全长光纤，两端的短段可能不能满足筛选试验期间的所有技术

要求，如最大卸载时间，应该在筛选试验后去掉。短段试样光纤长度的典型值小于 50m。

筛选试验后，光纤的完全断裂证明光纤受到破坏。检验光纤断裂的方法包括：目视检查和 OTDR 测量。将断裂区去除后，经受住的光纤长度被认为通过了筛选试验。如果筛选机经张力校准，可由式 (5.13) 求出应力，由式 (5.12) 求出应变。

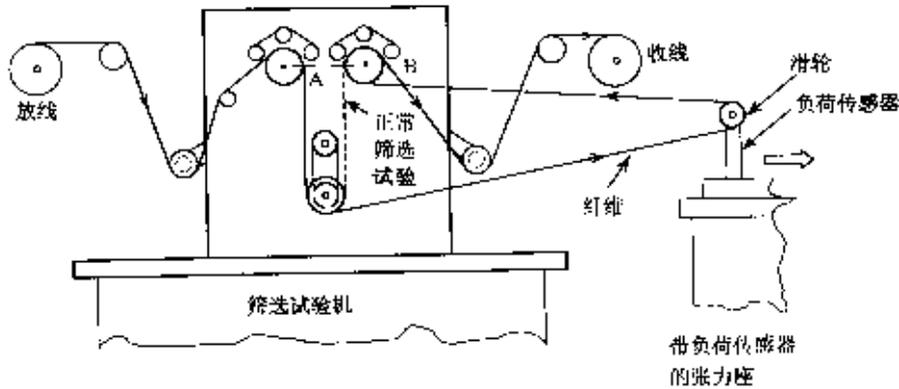


图 5.5 增加光纤受试长度的方法

涂覆光纤机械强度筛选试验分级要求应符合表 5.1 的规定。

表 5.1 光纤强度筛选试验分级

等 级	I	II
筛选应力不低于 GPa	0.69	1.38
筛选应变不低于%	1.0	2.0

注：上述两种表示方法是等效的

(2) 抗拉强度

① 测量原理

筛选试验只是保证了光纤的最低强度，在一根实际的石英玻璃光纤表面，存在着许多微裂纹，简单地对光纤施加张力，那么沿着光纤长度方向和在光纤的横截面积中均匀地存在着应力。我们也可以用光纤断裂累积概率的威泊尔分布来表征光纤的强度，即：一定长度的光纤，在应力 σ 的作用下，光纤的断裂累积概率可用威泊尔分布来描述。

$$F(L, \sigma) = 1 - \exp \left[- \frac{L}{L_0} \left(\frac{\sigma}{\sigma_0} \right)^m \right] \quad (5.15)$$

式中：F 为小于或等于 σ 的应力下光纤断裂的累积概率； σ_0 是在“标距”长度 L_0 下测得的，与 e^{-1} 或 36.8% 的累积概率相对应的强度； L_0 、 σ_0 和 m 均为常数。

为获得不同长度光纤断裂概率的威泊尔分布，必须对光纤试样作拉力试验。将光纤试样拉断，记下断裂的应力值，最后根据记录统计光纤在不同拉力强度下

断裂累计概率分布，作出威泊尔分布曲线（参看 5.2.2 节），并用其来判断光纤抗拉强度和使用寿命。

② 试验装置

光纤抗拉强度的试验装置为一台合适的拉力机。拉力机的拉伸方向可以是垂直的或水平的。拉力机的拉伸速度每分钟应为试样长度的约 3%~5%。夹持光纤可用卡盘或其他合适的方法，光纤夹具应不使光纤试样损坏和打滑。

③ 试验程序

应使制备的试样受试长度达到 1m（短试样）或 10~20m（长试样）。如果需要，试样可在温度 20℃的自来水槽中或在气候室（如控制温度 23℃和相对湿度 95%）中作预处理。预处理时间应不少于 24h。

● 试验 A:

试验 A 适合于试样不要求作预处理的情况。试验前，先将试样安置在拉力机上，两夹具之间的光纤自由长度应达到 1m 或 10~20m。拉伸速度按光纤产品规范中的要求。

● 试验 B:

试验 B 适合于试样要求作预处理的情况。试验时，将试样从预处理装置中取出后的 5 分钟内将其安置到拉力机上，两夹具之间的光纤自由长度应达到 1m 或 10~20m。拉伸速度按光纤产品规范中的要求。

未老化光纤的最低抗拉强度应符合表 5.2 中的规定。

表 5.2 未老化光纤的最低抗拉强度 (GPa)

光纤标距长度 (m)	威泊尔概率水平	
	15%	50%
0.5	3.14	3.80
1.0	3.05	3.72
10	2.76	3.45
20	2.67	3.37

二、疲劳参数

1. 定义

在一定应力条件下，光纤表面微裂纹生长扩大至光纤断裂的过程称为光纤的疲劳。通常，按施加应力的模式光纤的疲劳可分为：静态疲劳和动态疲劳。人们常常用静态疲劳参数和动态疲劳参数来表征光纤的疲劳性能。

2. 测量方法

任何光纤的疲劳试验都应在尽可能接近实际应用的模拟条件下确定断裂应力和疲劳性质。ITU-T G. 650 推荐的疲劳参数的试验方法有：动态疲劳的轴向张

力法、动态疲劳的两点弯曲法、静态疲劳的轴向张力法、静态疲劳的两点弯曲法和静态疲劳的均匀弯曲法。

鉴于本书篇幅限制，我们仅介绍国内通用的动态疲劳轴向张力法和静态疲劳轴向张力法，以飨读者。

(1) 动态疲劳参数的轴向张力测试法

① 测量原理

轴向张力法是用来确定光纤在规定的恒定应变速率下的动态疲劳参数。轴向张力法测量原理是通过改变应变速率来检验光纤的动态疲劳性能。这个试验方法适用于断裂应力值的对数与应变速率的对数呈线性关系的那些光纤和应变速率。

② 试验装置

轴向张力法测定光纤动态疲劳参数 n_d 的试验装置，如图 5.6 所示。试验装置的主要组成有：试样夹持装置、力值传感器、可变速度驱动装置等。

A. 试样夹持装置

选择一种用弹性材料套覆盖表面的合适轮子来夹持光纤。不受试验的一段光纤围绕轮子缠绕几圈，端头用弹性或胶粘带固定。光纤绕在轮子上不得交叉。光纤伸长前两轮轴芯之间的光纤长度定为标距长度。

确定轮子和滑轮直径的原则是，缠绕在轮子上的光纤不应受到能引起光纤断裂的弯曲应力。对典型的石英玻璃光纤，光纤缠绕在轮子上或绕过滑轮时，弯曲应力不应超过 175MPa（对 125/250 μm -包层/涂覆层石英玻璃光纤，最小的轮子直径为 50mm）。轮子表面应有足够的刚性，以保证充分加载时，光纤不会切割表面。

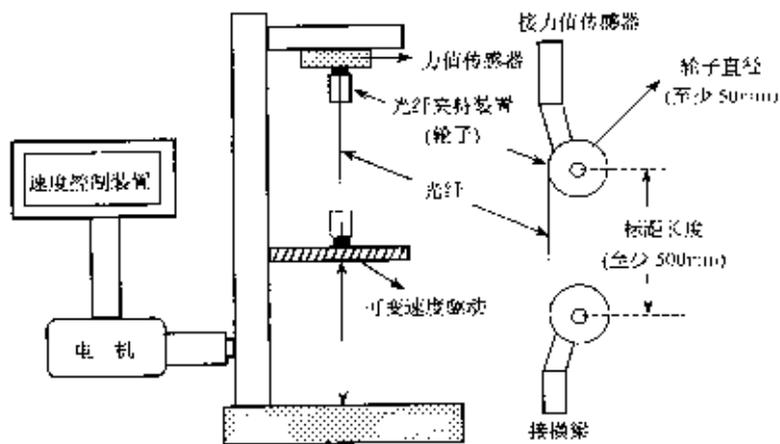


图 5.6 动态疲劳轴向张力法试验装置

B. 力值传感器

力值传感器用来测定每根被测光纤在轴向张力拉伸过程中直至断裂时的抗拉应力。力值传感器应与光纤受到负载时的同样方式进行定标和定向。在恒定的

速率下移动一个或两个轮子来增加夹持轮子之间的间距,其初始间距等于光纤的标距长度。标定力值传感器重量包括断裂负载或最大负载(最大负载的50%、最大负载、大于最大负载50%)。

C. 可变速度驱动装置

速度控制单元的设定应通过试验确定,以符合规定的应变速率。应变速率应用单位时间标距长度的百分数来表示。选择有效的最大应变速率时,应考虑试验方法的各个方面,诸如设备的能力及试样的材料特性等。

缩短试验周期的方法是使用较快的应变速率和较低的负载。例如,规定的应变速率为0.025%/min,先用次快速率(0.25%/min)来试验一些试样,以建立断裂应力范围;然后用次快速率把光纤预加载到等于或小于在此速率下找到的最低断裂应力的80%;最后按规定的应变速率进行试验直至光纤断裂。

③ 试验程序

所有试样应在试验环境中至少预处理24h。试验应在恒定的环境条件下进行。试验期间,温度的标称值应在 $20 \sim 23 \pm 2^\circ\text{C}$ 之内;相对湿度的标称值应在40%~60±5%之内;为获得可靠的实验结果,要求相对湿度的标称值靠近50%RH。

轴向张力法测量光纤动态疲劳参数的试验程序下:设定和记录标距长度,设定和记录应变速率,将夹持轮返回到标距长度的间隔位置。将光纤试样两端依次安装在夹具上。光纤的切线点应与负载标定时处于同一位置。引导每根试样,在卡盘上至少缠绕要求的圈数,各圈不得互相交叉。将负载记录仪置于零位。启动电机拉伸光纤,记录应力与时间的关系曲线,直至光纤断裂,关掉电机。对试样组的所有光纤重复上述试验程序,以获得所有的光纤应力与时间的关系曲线。动态疲劳参数的计算步骤如下:

A 断裂应力

当忽略涂层效应(小于5%)时,对通用包层直径为 $125 \mu\text{m}$ 、涂覆层直径为 $250 \mu\text{m}$ (聚合物涂覆层)的光纤,可用下式计算断裂应力 σ_f :

$$\sigma_f = T/A_g \quad (5.16)$$

式中: T—涂覆层光纤试样的断裂张力;

A_g —玻璃光纤的标称横截面积。

B. 给定应变速率下的断裂应力

绘制表征总体的威泊尔分布曲线需按以下步骤进行:

a. 将断裂应力从最低至最高值依次排列好,并按顺序给定一个序号k,即第一号为最低断裂应力,第二号为低断裂应力等等。即使几个试样的断裂应力相同,也要对其给定不同的序号。

b. 计算每一断裂应力的累积失效概率 F_k :

$$F_k = (k-0.5)/N \quad k=1, 2 \quad (5.17)$$

式中：N—样本大小。

- c. 在威泊尔概率纸上绘出 $\ln[-\ln(1-F_k)]$ 对 $\ln(\sigma_f)$ 的威泊尔曲线。
- d. 曲线上标出所需数据。

对给定标距长度和直径的试样，动态疲劳的威泊尔曲线与下述累计概率函数有关：

$$F_k = 1 - \exp[-(\sigma_f / \sigma_0)^m d] \quad (5.18)$$

设 $k(P) = PN + 0.5$ 来定义一个与给定概率 P 有关的序号。若 $k(P)$ 为整数，令 $\sigma_f(P) = \sigma_{F_{k(P)}}$ 为第 $k(P)$ 序号的断裂应力。若 $k(P)$ 不为整数，令 k_1 为低于 $k(P)$ 的整数，且 $k_2 = k_1 + 1$ 。然后，令

$$\sigma_f(P) = (\sigma_{f_{k_1}} \sigma_{f_{k_2}})^{1/2}$$

中值断裂应力为 $\sigma_f(0.5)$ 。威泊尔斜率为：

$$md = \frac{2.457298}{\ln[\sigma_f(0.85)] - \ln[\sigma_f(0.15)]} \quad (5.19)$$

式中： $\sigma_f(0.85)$ —累积失效概率为 0.85 时的断裂应力；
 $\sigma_f(0.15)$ —累积失效概率为 0.15 时的断裂应力。

威泊尔参数为：

$$\sigma_0 = \exp\left[\frac{0.366512}{m_d} + \ln[\sigma_f(0.5)]\right] \quad (5.20)$$

绘出每种应力速率的威泊尔分布曲线，确定每种应力速率的中值断裂应力 $\sigma_f(0.5)$ 。

动态疲劳参数 n_d 的计算为中值断裂应力 $\sigma_f(0.5)$ ，通常会随恒定应力速率 σ_a 按下式变化：

$$\lg \sigma_f(0.5) = \frac{\lg \sigma_a}{1 + n_d} + \text{截距} \quad (5.21)$$

式中：截距为单位应力速率下断裂应力的对数，如图 5.7 所示。

按 ITU-T G. 650(2000) 规定光纤的动态疲劳参数 n_d 应不小于 20。

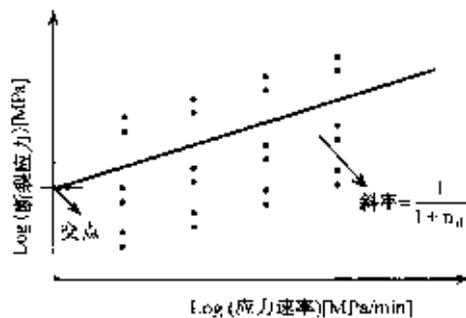


图 5.7 断裂应力与应力速率的动态疲劳参数曲线

(2) 静态疲劳参数的轴向张力测试法

① 测量原理

轴向张力法又可以用来确定单根光纤段张力下的静态疲劳参数。轴向张力法测量光纤静态疲劳参数的测量原理是通过改变施加的应力大小来检验光纤的静态疲劳性能。

② 试验装置

图 5.8 所示的是两种轴向张力试验装置。每种试验都由光纤夹具对光纤施加应力和监测光纤断裂时间部分构成。由图可知，受试光纤的标距长度，即两个光纤卡盘之间的距离应 500mm。

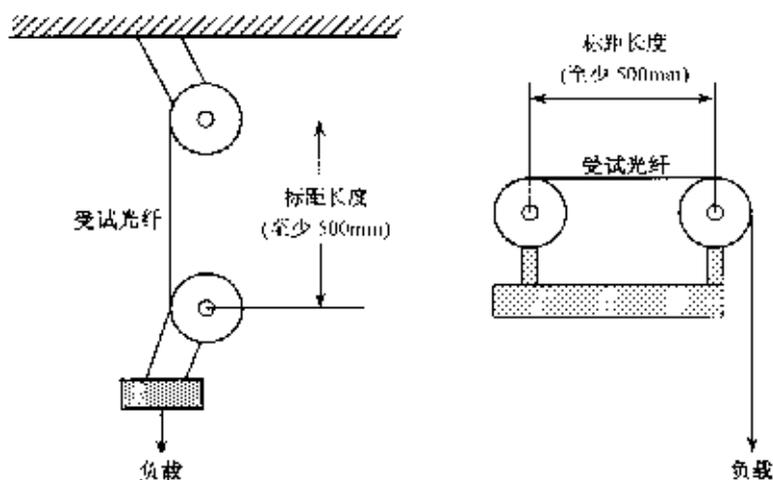


图 5.8 静态疲劳轴向张力法试验装置

光纤夹具如图 5.8 所示。施加应力的方法是用已知重量悬挂在一个轮子上给光纤施加应力。

在对光纤施加应力的悬挂重物下放置记时器用来测量光纤断裂时间。

③ 试验程序

每个标称应力水平下的样本大小应至少为 15 个光纤试样。应对至少五种不同的标称施加应力水平 σ_0 进行试验。标称应力的选择应使其中值断裂时间大约从 1 小时 ~ 30 天，使得在对数坐标纸上有大约相等的间距。对标准的石英玻璃光纤，达到这一要求的负载范围为 30 ~ 50N。

由于断裂时间取决于光纤断裂应力和疲劳参数，所施加的实际标称应力水平和施加的应力水平的个数能反复来确定。换句话说，开始试验时可以用一个宽的应力水平范围，将断裂太快或太慢的试验数据舍去。

样品作完预处理之后，安装在试验装置上，监测并记录每根光纤断裂的时间。对一样品组在给定的标称应力水平下进行试验时，只要中间样品已断裂，就可提

前中止试验。若多半样品已断裂,在所有余留样品断裂以前就可进行计算并确定中值断裂时间。断裂应力和静态疲劳参数 n_s 的计算步骤如下:

A. 断裂应力

断裂应力与动态疲劳参数中计算方法相同。

B. 静态疲劳参数 n_s

样品中值法不需假设威泊尔斜率为线性。对每种标称应力水平 σ_i 对应的中值断裂时间 t_i 就被确定。用最小均方差的方法把数据拟合到下面线性回归模式:

$$-n_s \ln(\sigma_i) + \text{截距} = \ln(t_i) \quad (5.22)$$

上式中的截距值为:

$$\text{截距} = \text{中值}[\ln(t_i)] + n_s \cdot \text{中值}[\ln(\sigma_i)] \quad (5.23)$$

三、可剥性

1. 测量原理

光纤的可剥性的测量原理是利用立式拉力机提供受试光纤和剥离工具之间的相对运动来定量确定沿光纤纵向机械剥去保护涂覆层所需的力。

可剥性试验主要用于检验具有预涂覆层的光纤或具有其他被覆层光纤的涂覆层或被覆层剥离的难易程度。

2. 试验装置

光纤涂覆层剥离试验装置,如图 5.9 所示。试验装置主要有:拉伸装置、力值传感器、转换放大器和剥离工具等。它们的工作作用如下所述。

(1) 拉伸装置

使用一台合适的拉力机(如立式拉力机)来提供受试光纤与剥离工具之间的相对运动。拉伸装置应能提供恒定的剥离速率,没有猛拉受试光纤或剥离工具的现象。拉伸装置还能提供两个方向的相对运动,以便复位。剥离工具应在拉伸装置的夹头上夹紧,其刀刃与光纤轴垂直。为防止光纤弯曲,牢固夹紧受试光纤的另一端。

(2) 力值传感器

采用一台合适的能检测出剥去光纤涂覆层时施加于光纤的力的传感器。

(3) 转换放大器

转换放大器接收来自力值传感器的信号,并能显示出被测光纤涂覆层剥除时的剥离力,力值读数应是连续的。例如,用一台曲线记录仪记录最大力和平均力,以及剥离中力值波动的幅度和频率。

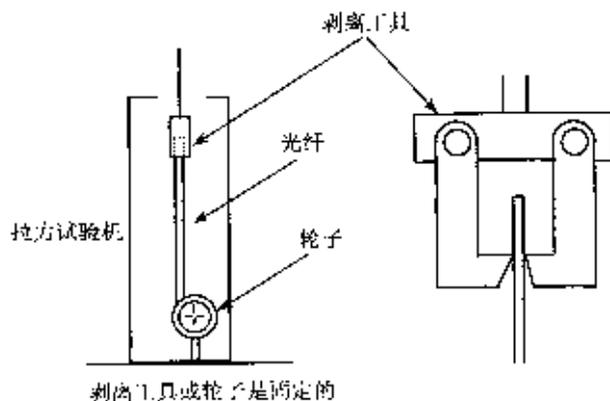


图 5.9 光纤涂覆层剥离试验装置

(4) 剥离工具

试验结果的准确性主要取决于剥离工具的设计。剥离工具应做到不损伤光纤包层表面，刀刃直径大于被剥离光纤标称包层直径 $50\ \mu\text{m}$ 。剥离工具刀刃应不引起光纤弯曲，刀刃对接在同一平面上为最佳状态。剥离工具应安装在拉力机固定架上，刀刃磨损到影响试验结果时，应予以更换。

3. 试验程序

试样应能代表总体光纤，以便作出正确的质量评估。由于试验的可变性，故至少取 10 段试样做试验，然后取平均值得到该试样的试验结果。

所剥光纤长度会影响剥离力。对于标称涂覆层直径为 $250\ \mu\text{m}$ 的光纤，所剥光纤长度对剥离力影响很小。光纤的剥离长度规定为：对于标称涂覆直径为 $250\ \mu\text{m}$ 的光纤，可取的值为 20mm、30mm 和 50mm；对于有较粗的涂覆层直径的光纤，可选取较短的剥离长度。

试样总长度由光纤固定端与剥离工具间的距离，要通过剥离工具所规定的待剥光纤长度和在固定端把光纤绕到轮子上所需的长度来确定。试验结果部分取决于光纤的剥离长度，与试样总长度无关。

从光纤上剥去涂覆层所需的力部分取决于剥离速率。如果要比较不同试验的结果，应采用相同的剥离速率。拉伸试验应按规定的速率在光纤与剥离工具之间提供相对运动（对于标称涂覆层直径为 $250\ \mu\text{m}$ 的光纤，可取的值为 100mm/min 或 500mm/min，较粗涂覆层直径的光纤剥离速率或取 100mm/min）。试样应在 $25\pm 5\ ^\circ\text{C}$ 的温度和 30%~60% 的相对湿度下至少预处理 24h。每组试样光纤试验前，应按设备仪器使用说明书标定转换器和力值传感器。安装之前，剥离工具两刀刃周围的区域应无残渣和/或累积物。

试验光纤的一端应紧固在试验夹具上，使其在加载时不打滑（例如光纤在直径为 80mm 的轮子上绕三圈）。光纤的另一端穿过剥离工具，并插入到光纤导向孔中。距光纤端头规定的距离处切开涂覆层。启动拉伸机，在光纤和剥离工具之间提供一个恒定的相对运动，从光纤上剥去涂覆层。观察、测量记录剥去玻璃光纤涂覆层所需的力，要去除试验期间光纤断裂情况下的数据。当涂覆层完全从光纤

上剥去时，试验完成。

GB/T 9771.1~.5-2000 规定单模光纤涂覆层所需的剥离力峰值宜在 1.3~8.9N 范围内。

四、光纤的翘曲

1. 定义

光纤的翘曲是剥除预涂覆层后的石英玻璃裸光纤自然弯曲的曲率半径，以米表示。

光纤的翘曲特性是由于光纤制造过程中的高速拉制和骤然冷却过程致使光纤中产生内应力，即淬火造成的裸光纤固有的一种弯曲特性。

为了更好地理解光纤翘曲的物理意义，我们以一圆形的模型来解析光纤的翘曲。光纤翘曲的圆形模型，如图 5.10 所示。当光纤进行熔接时，需要将待熔接的光纤端头上的涂覆层剥去，然后将其放在熔接机中的 V 型槽中的光纤定位器上夹好，被熔接的裸光纤将伸出一段长度为 x 。由于石英玻璃裸光纤固有的自然弯曲（翘曲）特性，光纤的自由端就会偏离光纤固定器的轴线一定距离 δ_f 。我们假设光纤伸出段弯曲后形成一个以 R 为半径的圆周上的一段圆弧，这样我们就可以借助图 5.10 所示的圆形模型来求出光纤的曲率半径（翘曲） R 的值。由图 5.10 得知，三角形 ABC 是一直角三角形，AB 是斜边，长度用 c 表示则有：

$$c = (x^2 + \delta_f^2)^{\frac{1}{2}} \quad (5.24)$$

又知三角形为一等腰三角形， OC' 为底边上的高，三角形 ABC 的角 α 等于三角形 AOC' 的角 α ，则有：

$$\sin \alpha = \frac{\delta_f}{c} = \frac{(c/2)}{R} \quad (5.25)$$

将式 (5.24) 代入式 (5.25) 则可将光纤的曲线半径（翘曲） R 的表示式为：

$$R = \frac{(x^2 + \delta_f^2)}{2\delta_f} \quad (5.26)$$

利用式 (5.26)，只要测出裸光纤的伸出长度 x 和偏移距离 δ_f ，我们就可以计算出光纤的翘曲度参数 R 。

(1) 侧视显微技术

① 测量原理

侧视显微技术测量光纤的翘曲的测量原理是通过确定未支撑光纤端头绕光纤轴旋转时产生的偏离量来确定未涂覆光纤的曲率半径（翘曲）。在已知光纤最大偏离量和从光纤夹具到测量点的悬空距离，用一个简单的圆模型就能计算出光纤的曲率半径（参看图 5.10）。

② 试验装置

侧视显微技术中的光学显微镜测量光纤翘曲试验装置，如图 5.12 所示。试验装置的主要组成部分有：光纤夹具、旋转夹具、偏离测量装置、摄像机、监视器和视频分析仪等。

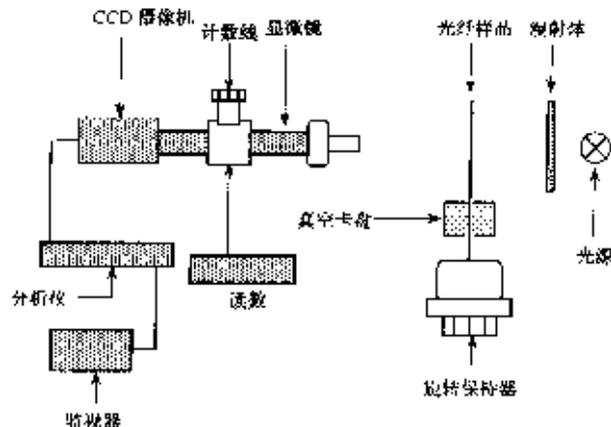


图 5.12 光学显微镜测量光纤翘曲试验装置

A. 光纤夹具

用一合适的夹具来保持试样光纤在一个恒定的轴上并允许光纤旋转 360° 。夹具可以由 V 型槽，例如真空卡盘或一光纤套筒组成。若使用套筒，为减小测量偏离的易变性，需保证内径与光纤外径的配合公差足够小。

B. 旋转夹具

采用一旋转夹具夹住光纤一端，并能提供将试样旋转 360° 的精确方法。该装置可以手动操作，或靠步进电机驱动。

C. 偏离测量装置

提供一种来测量光纤旋转 360° 时偏离的装置。该装置由可视显微镜组成。若采用可视显微镜，要提供允许精确测量光纤偏离的方式。例如测微目镜或图像分析系统。

D. 摄像机和监视器

摄像机和监视器可用于增强手动或自动操作的可视系统功能。

E. 视频分析仪

采用视频图像分析仪，可提供更精密的测量线定位

F. 计算机

可用计算机系统进行过程控制、数据收集和计算。

③ 试验程序

试样应是一段适当长度的未成缆光纤，其一端应剥去足够长度的涂覆层，使之能安装在夹具上并有适当悬空长度。

将裸光纤端安放在光纤夹具中，端头伸出夹具外适当的悬空距离，典型悬空距离是 10~20mm。试样另一端固定在旋转装置上。

旋转试样直到偏离读数是在最大或最小位置，记录此时的偏离值 D_0 ；在旋转试样约 180° 直到偏转读数是在另一极端位置，记录偏离值 D_1 。

偏离量 δ_f 可由下式计算：

$$\delta_f = \frac{D_0 - D_1}{2} \quad (5.28)$$

式中： D_0 和 D_1 分别是最小偏离值和最大偏离值。

因为测量任何样品的总光纤偏离量将取决于悬空距离 x ，采用圆模型把光纤翘曲作为曲率半径 R_c 进行计算是方便的。

$$R_c = \frac{x^2 + \delta_f^2}{2\delta_f} \quad (5.29)$$

式中： R_c —曲率半径；

x —悬空距离；

δ_f —光纤偏离量。

(2) 激光束散射法

① 测量原理

激光束散射法测量裸光纤曲率半径（翘曲）的测量原理是用激光束散射，通过线传感器读出反射光束之间的距离，再将其有关参数代入光纤曲率半径（翘曲）计算公式，从而求出未涂覆光纤的翘曲。

② 试验装置

激光束散射法测量光纤翘曲的试验装置，如图 5.13 所示。试验装置主要由光源和检测器组成。

A. 光源

光源选用的是分离的氦氖激光束作为光源，由一只氦氖激光器、光束分离器和一个三棱镜组成。

B. 检测器

采用像电荷耦合器件线性传感器一类的图像传感器作检测器。

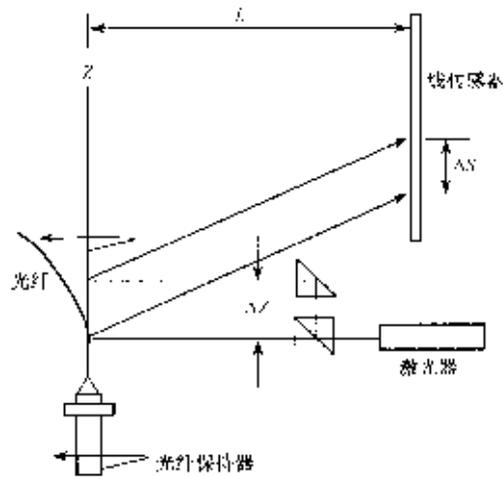


图 5.13 激光散射法试验装置

③ 试验程序

光纤试样被固定在一个旋转夹持器中，夹持器应允许试样光纤绕夹具的轴旋转 360°。裸光纤固定在试样夹持器中并竖直延伸出夹持器一个规定的悬空长度。用一根非翘曲光纤给出系统的标定因子。

光纤试样旋转时，通过线性传感器读出两反射光束之间的距离。将最大反射光束距离记作 Δs 。光纤的曲率半径可由下式求出：

$$R_c = \frac{2L}{\frac{\Delta s}{\Delta z} - 1} \quad (5.30)$$

式中： R_c —光纤的曲线半径；

L —光纤和线传感器的距离；

Δs —反射光束距离；

Δz —入射光束距离。

按国家有关光纤性能的规定，光纤的翘曲度宜大于 4m。

第六章 光纤带机械性能

第一节 光纤带机械性能测试的目的

众所周知，光纤带是由紫外光固化涂覆光纤和紫外光固化粘结材料共同组合的线性矩阵。如果光纤带在成缆、施工、使用、维护中受扭转、残留扭转等外力作用，那么会影响光纤的传输性能和机械使用寿命。同时，光纤带在施工、维护

中应具有可分离性，即光纤能从光纤带中分离成若干根光纤的子单元或单根光纤。光纤带便于剥离，即光纤涂覆层及光纤带粘结材料能容易地剥除。

这样，光纤带机械性能包括：可分离性、可剥离性、抗扭转能力和残余扭转度。研究光纤带机械性能的目的在于，从光纤带结构出发，通过模拟光纤带在成缆、施工中受扭转等条件进行必要的试验来确保光纤带的传输、机械性能及使用寿命。

第二节 测量方法

国内外有关标准中介绍的验证光纤带机械性能优劣的试验方法有：光纤带的可分离性、光纤带剥离性、光纤带抗扭转能力和光纤带残余扭转度。本章将简要介绍这些试验的测量原理、试验装置和试验程序。

一、光纤带可分离性

1. 测量原理

光纤带可分离性试验的测量原理是利用一工具或手工将未老化的 6 芯或 12 芯或 24 芯光纤带中的光纤分离成单根或多根光纤的子单元。

光纤带可分离性试验的目的有两个：(1) 保证要求分离的光纤带具有足够的抗撕裂性能。(2) 确保要求分离的光纤带具有可分离成单根光纤或多根光纤子单元的可分离性。

2. 试验装置

光纤可分离性试验装置应包括一个具有合适夹具的张力强度测量装置和一个放大倍数为 100 倍的显微镜。

3. 试验程序

对于 n 芯光纤带，从被测的每个约 1m 长的光纤带试样上截取最小长度为 100mm 的光纤带试样，共取 $n/2$ 段试样；对 m 批光纤带，光纤带试样数共有 $m \times n/2$ 个。

对于 x 个光纤带试样（从批次中抽取，在产品规范中， x 一般规定为 3~5），用刃器将被试光纤带中光纤一根根与光纤带中其他光纤分开至长度为 25~30mm，以便于试验时夹持，如图 6.1 所示。对于 x 较多的光纤带试样，要将光纤带中光纤两根两根地与光纤带中其他光纤分开，直至分出的光纤根数为被测试光纤带芯数的一半，即 $n/2$ 。

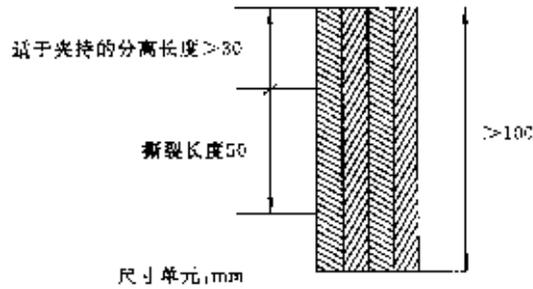


图 6.1 可分离性试验试样制备

可分离性试验程序如下：将每个试样插入强度测量装置上，如图 6.2 所示，在分离起始点约 3mm 处位置将分开的光纤夹住，以 100mm/min 的速度慢慢地将光纤撕开至 50mm 的长度，并连续记录 50mm 的长度上的撕裂力。用显微镜检查可分离性，即光纤带撕裂后预涂覆层和着色层受损的情况。最后，比较所测的各光纤所需撕裂力的大小。

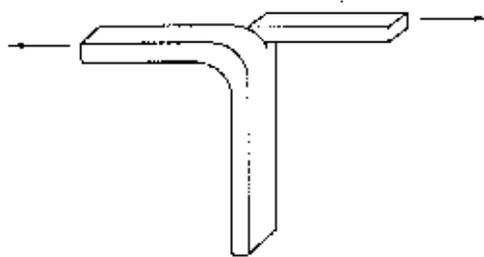


图 6.2 光纤带可分离（撕裂）试验示意图

评定光纤带可分离性优劣条件有：不使用特殊工具或器械就能完成光纤带的分离。完成撕开时所需的应力不超过 4.4N。光纤分离过程不应对光纤的传输和机械性能造成永久性的损伤。在分离试验后光纤着色层允许有点脱落，但在任意 2.5cm 长度的光纤上应留有足够的便于光纤带中各光纤相互区别的色标。

二、光纤带可剥离性

1. 测量原理

使用专用的剥离工具，从未老化和老化的光纤带上，以机械的方式剥去一段长度大于 25mm 光纤带的粘结材料、着色层和光纤预涂覆层，以验证光纤带的可剥离性的优劣。

2. 试验装置

光纤带可剥离性的试验装置为一专门的剥离工具和用来擦去光纤带上各涂覆层残留物的酒精。

3. 试验程序

受试光纤带试样预处理方法有两种：温度湿度老化法和水老化法。温度湿度

老化法是将受试光纤带浸泡在温度为 $85 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，非冷凝湿度为 $85 \pm 5\%$ 环境中停留 30 天。水老化法是将受试光纤带浸泡在温度为 $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 的去离子水或蒸馏水中持续 14 天。

光纤带可剥离性试验在标准大气压下进行。未经过老化、湿度老化和水老化光纤带的可剥离性试验应在老化后的 8 小时内完成。剥离后的光纤带的清洁应用酒精擦清光纤上的残留涂覆物，以使玻璃光纤能够熔接。可剥离性试验的试样最少为 10 个。

三、光纤带抗扭转

1. 测量原理

光纤带在成缆、敷设、使用和维护中不可避免地受到扭转的作用。光纤带抗扭转试验的测量原理是设法在光纤带上施加荷载，借助循环扭转来模拟光纤带实际扭转情况，以检验光纤带结构的机械和功能的完整性，确保光纤带经受扭转力作用后，光纤带中光纤不会分离成单根光纤或多根光纤子单元。

2. 试验装置

光纤带扭转试验的试验装置，如图 6.3 所示。该试验装置由两个竖直放置的光纤带定位夹具和为每根光纤施加 1N 张力的吊挂荷重器具组成。



图 6.3 抗扭转试验装置

3. 试验程序

从不同批次的光纤带中选取 5 个有代表性试样，每个试样长度为 340mm。将制备好的光纤带试样牢固地固定在试验装置中，两夹具夹持的光纤带距离为 300mm。试验时，先将顶端夹具顺时针旋转 180° 回到起始位置后，再逆时针旋转 180° ，然后再回到起始位置，这就构成一个循环扭转试验。扭转试验应重复进行 20 个循环，扭转速度为每分钟 20 个循环。

四、光纤带残余扭转

1. 测量原理

光缆中绞合的光纤带长度与敷设的光缆中的光纤长度相等。接入网中馈线和配线中所用的光缆要经受很宽的温度和湿度的作用。这种作用在光缆接续点或地

上标准终接点或接头盒处特别显著。光纤带必须在无扭转状态才能保持它们的尺寸完整性，允许重新排列或限制因光纤扭转引起宏观弯曲致使衰减增大。

光纤残余扭转的测量原理是在受试光纤带底部悬挂 1N 的荷载，使光纤带发生扭转，测量出扭转角 θ ，用扭转角 θ 除以光纤带试样长度就可以计算出光纤带的残余扭转。

2. 试验装置

光纤带残余扭转试验装置，如图 6.4 所示。该试验装置由两个夹具、一个加载重物和扭转角测量仪器组成。

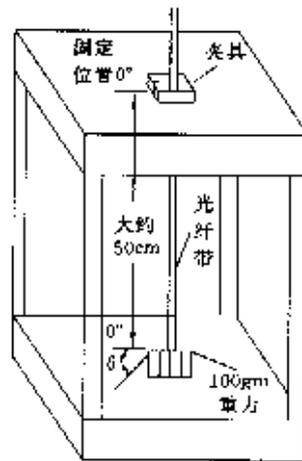


图 6.4 光纤带残余扭转试验装置

3. 试验程序

从被试光纤带中选取 5 个有代表性的试样，每个试样长度应不小于 50mm。将试样置于 85°C 下老化 30 天。

试验时，用夹具固定光纤带的顶部，并在光纤带底部加 1N 的荷重，使光纤带无扭转，记录下此时光纤带的位置，然后，卸除负荷，光纤带发生扭转，测量扭转角 θ ；用 θ 角除以光纤带试样长度计算出光纤的残余扭转。

第七章 光纤的环境性能

第一节 光纤环境性能测试的目的

随着人们对信息需求的日益增长及光纤通信技术的日趋成熟，光纤光缆正在以架空、直埋、管道、沟道、隧道、水下等敷设方式在各种各样的实际使用环境中，织制着纵横交错的光缆网络。光纤光缆跨越各种温区，要能经受不同环境条件的作用。

为确保光纤能在各种严酷环境条件下正常工作，我们应该模仿光纤实际使用

场所的温度、潮湿、高温高湿、高温、核辐射等环境条件设计出温度循环、浸水、高温高湿、高温、核辐射等试验来检验光纤对气候的适应性、耐核辐射等性能是否符合要求。

人们正是在充分研究光纤的环境性能的基础上，设法改进光纤的材料选择、结构设计、制造工艺、正确选择涂覆、套塑材料及相应的涂覆工艺和合理选择光缆材料、光缆结构和成缆工艺。如果我们从理论和试验中找出致使光纤环境性能下降的原因所在，那么改善光纤环境性能的办法也就指日可待了。

第二节 测量方法

光纤环境性能试验主要包括温度循环、浸水、高温高湿、核辐射等。温度循环试验用来验证光纤的气候适应性能，浸水试验是考察光纤的耐水侵蚀性能，高温高湿试验则是判断光纤耐高温高湿作用的性能，高温试验是用来评价光纤耐高温的性能，核辐射试验用以检测光纤耐 γ 射线辐射的耐辐照性能。下面对光纤环境性能的测量原理、试验装置和试验程序等作简单介绍。

一、温度循环

1. 测量原理

光纤温度循环试验的测量原理是通过模拟光纤在储存、运输和使用期间可能经受的最坏温度变化来确定 A1a-A1d 多模光纤和 B1-B4 单模光纤对温度变化的衰减稳定性，即光纤的衰减温度特性。

光纤的温度衰减特性试验是将受试的整筒光纤放在气候室内，在温度循环试验规定的温度范围内进行温度循环试验，以确定温度变化时，光纤的附加损耗量。

温度循环试验结束后，可按下列式计算出光纤的平均附加损耗：

$$\Delta\alpha(\lambda) = \frac{10}{L} \log \frac{P}{P_0} \quad (\text{dB/km}) \quad (7.1)$$

式中：P—分别在试验点 T_A 、 T_B 、保温后的稳定光功率；

P_0 —参考温度 T_0 的光功率；

L—试样长度。

另外，我们还可以用光时域反射计 (OTDR) 直接测量不同温度点的 OTDR 曲线，从而确定光纤的温度附加损耗量。

2. 试验装置

光纤的温度衰减特性的试验装置主要由衰减测量装置和气候室组成。

(1) 衰减测量装置

应采用 GB/T 15972.4-1998 《光纤总规范第 4 部分：传输特性和光学特性试验方法》中规定的传输功率监视法和 GB/T 15972.4 规定的后向散射法中的衰减

测量装置来测定被测光纤的温度衰减变化。

(2) 气候室

气候室的体积大小应适合容纳被试光纤线盘，气候室的温度应地规定试验温度范围内，其温度控制精度应在 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 内。采用强制空气循环来维持气候室内温度均匀，气候室的设置及辅助设备的安放要避免冷凝水滴落到受试光纤试样上。

3. 试验程序

试样为出厂长度或按产品规定的长度，并应为可达到所需试验准确度的适当长度。建议被试光纤最短长度为：多模光纤(A1a ~ A1d)应不短于1000m，单模光纤(B1 ~ B4)应不短于2000m。

如果受试光纤经滑石粉处理，那么应从该试样光纤中抽出一段未涂抹滑石粉的光纤进行试验。为了得到具有重复性的试验结果，试验光纤应松弛地绕在线盘上并置于气候室内。试验结果可能会受到光纤弯曲半径的影响。基于这个考虑，试样松绕成卷并用滑石粉材料处理，以便使卷绕的紧挨各圈，彼此能自由地移动。受试光纤可以以水平或垂直方式绕成最小弯曲直径为150mm，以避免发生宏弯作用。

被测光纤试样放入气候室内，在规定的时间内经受各种温度变化。试验条件，如表7.1所示。

表 7.1 温度循环试验条件

预处理条件	温度测试条件	标称值 2h, 23°C, 50% RH
最低温度	T_A	-60°C 或 -40°C
最高温度	T_B	+85°C 或 +70°C
在每个温度下最小的持续时间	t_1	2h
最大的温度速率	斜坡速率	1°C/min
需要完成的循环次数	循环次数	2

试验具体步骤与内容大致如下：

试验前应将被试光纤试样置于正常试验大气环境中预处理时，目视检查外观，然后将试样光纤的两端分别与稳定光源和光检测系统连接好，待监测系统稳定后测定环境温度下的衰减基准值。

将处于环境温度下的试样光纤置入气候室，并将试样光纤两端引出气候室外，与稳定光源和光检测系统连接好或与光时域反射计连接好。再以适当的冷却速率将气候室温度降到规定的低温 T_A ，待室内温度达到稳定后，接着使试样光纤在 T_A 温度下保温适当的时间 t_1 ($t_1 \geq 2\text{h}$)。然后以适当的加热速率将气候室温度升高至规定的高温 T_B ，待室内温度稳定后，使试样光纤在 T_B 温度下保温适当的时间 t_1 ，再以适当的冷却速率将气候室温度降至环境温度。上述的降温、保温、升

温、保温过程构成了一个温度循环。如图 7.1 所示。

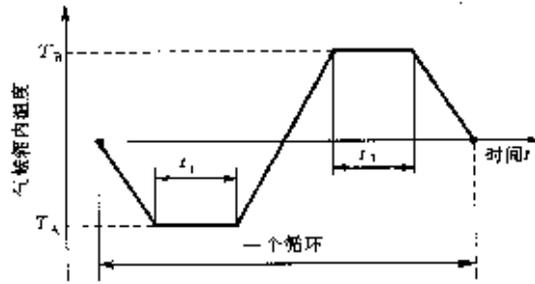


图 7.1 一个温度循环的试验气候室内温度循环曲线

在一个温度循环过程中要记录好温度点环境温度 T_A 、 T_B 下经过保温时间 t_1 后输出光功率 P_0 、 P_A 、 P_B 。

光纤温度衰减特性实验时，被测光纤试样应经历两个温度循环过程。试验结束后，按照式 (7.1) 计算出光纤的平均附加损耗量。

二、温度时延漂移

1. 测量原理

当今光纤光缆被广泛使用在不同的敷设方式和环境中，敷设方式有架空、管道、直埋、缆沟和水下等，使用环境温度为 $-50 \sim +60^\circ\text{C}$ ，因此要求光纤的性能要有高度的稳定性。长期以来，人们始终关心的光纤温度特性包括温度特性和时延温度特性。由于过去的光纤通信采用的是异步数字传输，不考虑时钟温度漂移问题。当今，随着光同步数字传输网的普及应用，人们开始重视时钟漂移问题，也开始研究光纤脉冲时延温度特性。尽管光纤的时延温度系数很小，但其对 40Gbit/s 速率的高速系统仍有影响。

众所周知，光脉冲通过长度为 L 的光纤的群时延为：

$$\tau = \frac{L}{V_g} = \frac{LN}{c} \quad (7.2)$$

式中： L 为光纤长度， N 为光纤材料群折射率， c 为真空中的光速。当温度发生变化时，群时延也发生变化，将时延 τ 对温度 T 求导可得：

$$\frac{d\tau}{dT} = \frac{1}{c} \left(L \frac{dN}{dT} + N \frac{dL}{dT} \right) \quad (7.3)$$

实际上，光纤时延温度的变化是一种慢变化，称为温度漂移。我们定义单位长度单位温度间隔时延变化量为光纤温度时延漂移常数，记作 K_f ，单位为 $\text{ps}/(\text{km} \cdot ^\circ\text{C})$ ，表示式为：

$$K_f = \frac{d\tau}{dT} \cdot \frac{1}{L} = \frac{1}{c} \left[\frac{dN}{dT} + \frac{N}{L} \cdot \frac{dL}{dT} \right] \quad (7.4)$$

式中：第一项是由于光纤材料群折射率随温度变化而引起的，第二项是由于光纤物理变化引起的。

温度时延漂移常数的测量原理是利用应变测量仪，在频域法中，测量同一波长下温度变化引起的正弦波调制信号的相位移 $\Delta\phi$ ，即：

$$\Delta\phi=2\pi f\Delta\tau =2\pi f k_f L\Delta T \quad (7.5)$$

将式(7.5)稍作变换得 k_f ：

$$k_f = \frac{\Delta\phi}{2\pi f L\Delta T} \quad (7.6)$$

式中： f 为调制频率； L 为试样光纤长度； ΔT 为温度间隔。

在一般情况下，时延随温度的变化并不完全是线性关系。试验时应多选择一些试验温度点，由测量取得的多组数据求出拟合曲线，从而确定不同温度间隔内的平均时延漂移常数。

2. 试验装置

光纤温度时延漂移常数的试验装置与色散测量试验装置基本相同。所不同的是光纤先后放入温箱和冰柜中，光缆放在人工气候室内。温度变化范围为 $-40\sim+60\text{℃}$ 之间。色散测量的是不同波长间的时延差，而温度时延漂移常数是测量不同温度下的时延差。光纤温度时延漂移常数测量用的试验装置是应变测量仪（色散测量仪加应变测量软件）。

3. 试验程序

光纤时延温度常数的试验方法与单模光纤色散系数的试验方法基本相同，所不同的是，对色散测量的是同一温度下（室温）不同波长间的时延差；对时延温度漂移，测量的是同一波长下（工作波长，如1310nm），温度变化引起的光脉冲时延的变化。

如将石英玻璃光纤的热膨胀系数、石英玻璃在1310nm处的群折射率和折射率随温度变化值代入式(7.4)可算出 $k_f \approx 36\text{ps}/(\text{km}\cdot\text{℃})$ ，式(7.4)估算 k_f 时，未考虑光纤预涂覆材料的影响，实际上，不同的涂覆材料和工艺，光纤的温度时延漂移常数相差很大，大约在 $30\sim 200\text{ps}/(\text{km}\cdot\text{℃})$ 之间。另外，成缆光纤的温度时延漂移常数会大一些，具体数值取决于光缆结构设计和填充材料。一般要求光纤的温度时延漂移常数以 $40\text{ps}/(\text{km}\cdot\text{℃})$ 为好。

三、浸水

1. 测量原理

光纤浸水试验的测量原理是通过将多模光纤(A1a~A1d)和单模光纤(B1~B4)浸入蒸馏水或去矿物或离子水中来模拟光纤在实际使用、储存和运输中可能遇到浸水环境条件来确定光纤的耐浸水适用性。

我们可以借助插入损耗法和后向散射法来测量经规定的浸水时间后浸泡的

光纤试样的衰减变化。

2. 试验装置

光纤浸水试验的试验装置主要由水箱和衰减测量装置组成。

(1) 水箱

浸泡光纤试验的水箱装满蒸馏水，去矿物质或离子水。水的 PH 值为 5.0 ~ 8.0。

(2) 衰减测量装置

应采用 GB/T 15972.4-1998《光纤总规范第 4 部分：传输特性和光学特性试验方法》中规定的插入损耗法和后向散射法中的衰减测量装置来测定浸水后的光纤衰减变化。

3. 试验程序

为确保光纤光传输性能测量的重复性，被测多模光纤 (A1a ~ A1d) 的最短长度为 1000m，单模光纤 (B1 ~ B4) 的最短长度则为 2000m。水箱外部的光纤试样长度越短越好。所制备的光纤试样不会影响到其受试结果。光纤试样应松绕成盘，而且光纤两端应保持在水外，试样光纤以最小弯曲直径 150mm 水平或垂直绕成盘，以防止引起宏观弯曲损耗。

光纤试样被放入充满水的水箱中，水温为 $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 。光纤试样在水箱中放置 30 天。接着，可以用插入法和后向散射法，在规定波长下，测量浸水前、浸水中和浸水后的光纤试样的衰减变化。

四、高温高湿

1. 测量原理

光纤高温高湿试验原理是通过模拟光纤在实际使用、储存和运输中可能经受到的高温高潮湿环境条件来确定适用性。

高温高湿试验是通过观察规定时间范围内恒温下高潮湿对光纤的作用，从而达到评价光纤的实用性能的目的。这个试验给出一个实用的方法。

2. 试验装置

光纤的高温、高湿试验的试验装置主要由气候室、增湿器和衰减测量装置组成。

(1) 气候室

气候室的体积大小应适应容纳被测光纤线盘，而且便于试验中测量装置的接入。同时，气候室也能在规定的精度内保持给定的高温和高湿。高温高湿气候室和辅助设备的安放应避免冷凝水滴落到光纤试样上。

(2) 增湿器

用去矿物质或去离子水来获得规定的湿度。试验装置的锈或腐蚀杂质都不应作用到光纤试样上。应该按照增湿器制造厂家说明书要求控制加到增湿器中的水

量。

(3) 衰减测量装置

采用 GB/T 15972.4-1998《光纤总规范第4部分：传输特性和光学特性试验方法》中规定的插入损耗法和后向散射法中的衰减测量装置来测定被测光纤的衰减变化。

3. 试验程序

为确保被测光纤光传输性能测量的重复性对被测多模光纤(A1a~A1d)的最短长度为1000m；对被测的单模光纤(B1~B4)的最短长度则为2000m。位于气候室外的光纤试样长度越短越好。如果气候室外的光纤试样长度超过试样光纤总长度的10%应记载于试验报告中。

光纤试样的制备不应影响到其被测的性能。光纤试样应松绕成线盘，而且被涂上例如滑石粉材料，以求线盘上的彼此紧靠的各圈光纤可自由移动，光纤试样可以以水平或垂直绕成最小弯曲直径为150mm的线圈，以免产生宏观弯曲作用。如果光纤试样用滑石粉处理，那么应从该光纤试样中抽一段未涂滑石粉的光纤，暴露到试验环境中进行试验。

高温高湿试验的试验条件为：温度为+85%，相对湿度为+85%，持续试验时间为30天。

受试光纤的衰减测量是在规定的波长下，用插入法或后向散射法测量试验前、试验中（一旦试样稳定在规定的温度和相对湿度下）和试验后的光纤衰减变化。

五、高温

1. 测量原理

光纤高温试验的测量原理是通过模拟多模光纤(A1a~A1d)和单模光纤(B1~B4)在实际使用、储存和运输中所经受的高温环境条件作用下，测量光纤衰减变化来确定光纤的适用性。这个试验目的是在给定的时间范围内观察高温对光纤的作用。

2. 试验装置

光纤高温试验的试验装置主要由高温箱和衰减测量装置组成。

(1) 高温箱

高温箱的体积大小应能容纳被测光纤线盘，并不会使辐射热直接作用到试样光纤上，且便于试验条件下测量装置的接入。高温箱还应具有在规定的精度范围内保持规定的温度的能力。可采用强制空气循环方法来保持高温箱内的温度均匀。

(2) 衰减测量装置

光纤高温环境下的衰减变化测量装置采用的是 GB/T 15972.4-1998《光纤总规范第4部分：传输特性和光学特性试验方法》规定的插入法和后向散射法中的

衰减测量装置。

3. 试验程序

为获得测量的重复性, 光纤高温环境下衰减变化测量所需多模光纤最短长度为 1000m, 单模光纤最短长度为 2000m。放在高温箱外的光纤试样长度应越短越好。光纤试样的制备应不影响在受试条件下的性能。建议将光纤试样松绕成线盘, 并用诸如滑石粉等材料涂抹, 以便使绕成的彼此紧靠的光纤圈可自由移动。光纤试样可水平或垂直地绕成一个最小弯曲直径为 150mm 的线盘, 以防产生任何宏观弯曲作用。如果试样光纤被涂抹滑石粉处理, 那么应从该试样光纤中抽出一段未涂抹滑石粉的光纤暴露到试验环境中进行试验。

光纤高温试验的试验条件: 温度为+85℃, 持续试验时间为 30 天。尽管高温试验不控制湿度, 但是试验开始时 35℃下相对湿度不低于 50%, 衰减测量是在规定的波长下, 用插入法或后向散射法来测量试验前、试验中(一旦试样稳定在规定的温度)和试验后被测光纤的衰减变化。

六、核辐照

1. 测量原理

为确保敷入有背景辐射和有害核辐射环境中的光纤能够安全可靠地工作, 有必要研究测量暴露在 γ 辐射环境中的成缆或未成缆单模光纤或多模光纤中产生的辐照感应衰减的增加。这主要是由于光纤玻璃缺陷部位俘获了辐射分解的电子和空穴造成的(即形成了色心)。

光纤核辐照测量原理是采用衰减测量中的截断法来确定光纤在环境背景下的辐照感应衰减。通过监测试样光纤暴露在 γ 辐照前后及期间的功率来实现光纤在有害核辐照环境下的辐照感应衰减。

由于光或热作用导致的色心减少产生了恢复效应(减小了辐照感应衰减)。恢复效应可在 $10^4 \sim 10^2$ 时间范围内发生, 这使得辐照引起的衰减变化特征变得很复杂。因为衰减与许多变量有关, 如: 试验环境温度、试样结构、施加于试样的辐射总剂量和剂量率以及测量衰减所使用的光谱。

2. 试验装置

两种辐照环境下的光纤核辐照试验装置, 如图 7.2 和 7.3 所示。两种试验装置主要由辐照源、光源、光滤波器/单色仪、光探测器、光功率计和辐射剂量计等组成。

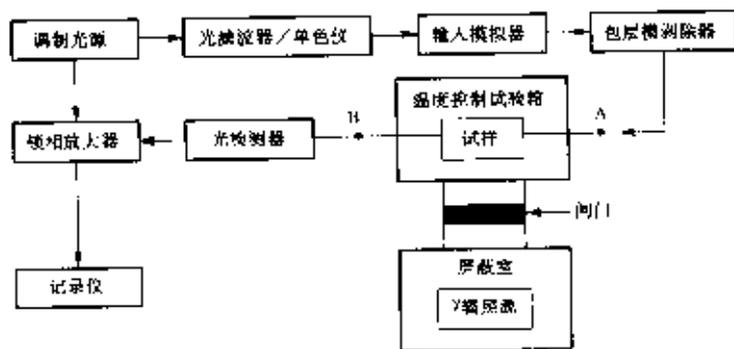


图 7.2 环境背景辐照试验装置

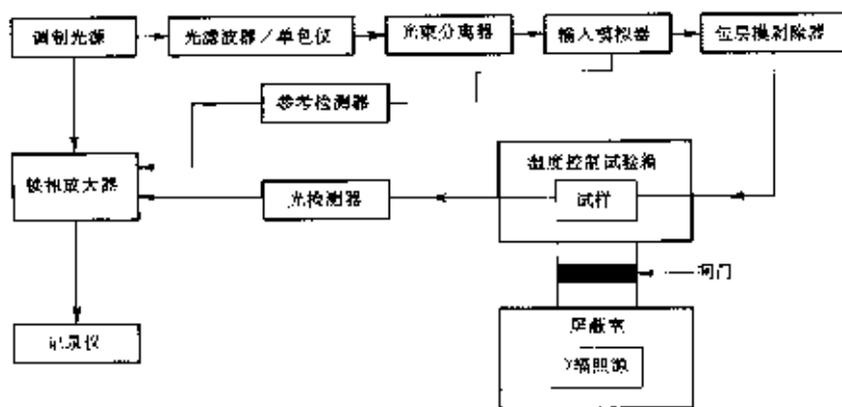


图 7.3 有害核环境辐照试验装置

(1) 辐照源

① 环境背景辐照试验

应采用一个 Co (钴) 或等效的电离源以不大于 0.2Gy/h 的低剂量率产生 γ 辐射。

② 有害核环境辐照试验

应采用一个 Co (钴) 或等效的电离源以 0.05Gy/s 至 2.5Gy/s 范围内所需的剂量产生辐射。

(2) 光源

应采用诸如卤钨灯、一组激光器或 LED 等光源来产生 850nm、1300nm(1310nm)、1550nm 工作波长。在完成测量的时间内，光源强度应保持稳定。从光源耦合到试验光纤中的功率应不大于 -30dBm (1.0 μ W)。光源应用占空比为 50% 的脉冲信号进行调制。

(3) 光滤波器/单色仪

应用一组滤光器材或一单色仪获得波长为 $850 \pm 20\text{nm}$ 、 $1300(1310) \pm 20\text{nm}$ 和 $1550 \pm 20\text{nm}$ 的光。滤光器 3dB 光谱宽度大于 25nm。

(4) 包层模剥除器

必要时，应在试样光纤输入端和输出端采用包层模剥除器以剥除包层模。如果光纤涂覆材料设计成可去除包层模（涂覆材料折射率略高于玻璃包层折射率），则不要求包层模剥除器。

(5) 光纤固定和定位装置

试样光纤应固定在能和真空吸盘能稳定支撑试样输入端的装置上，以便试样端可与输入光进行重复定位。

(6) 输入端注入模拟器

① 多模光纤（折射率渐变型）

应用一稳态模滤波器去掉高阶传输模，在光纤输入端建立稳态条件。

② 单模光纤

一光学透镜系统或尾纤可用于激励被试光纤。耦合进试样光纤中的光功率在试验期间应保持稳定。如果采用一光学透镜系统，一种使光纤定位较不敏感的方法就是对光纤输入端进行空间和角度的满注入；如果采用尾纤，可能有必要采用折射率匹配材料来消除干涉效应。应采用高阶模滤波器来滤除高阶模。

(7) 光探测器

应采用在接收光强范围内线性并稳定的光探测器。典型系统可包括采用电流输入前置放大器进行放大的光生伏打型光电二极管，由锁相放大器进行同步检测。

(8) 光功率计

应采用合适的光功率计测定从光源耦合进试样的光功率，确保它不大于 $1.0\mu\text{W}$ 或按产品规范规定的值。

(9) 辐射剂量计

应采用热致发光 LiF 或 CaF 晶体检测器 (TLD) 测定试样光纤接收到的辐射剂量。

(10) 温度受控试验箱

温度受控试验箱应能将规定温度保持在 $\pm 2^\circ\text{C}$ 以内。

(11) 试验线轴

试验线轴对本试验所采用的辐射不应起屏蔽或吸收作用。

3. 试验程序

试样置入试验箱以前，应对辐照源剂量均匀性和强度进行校准。将四个 TLD 置于辐照区，使它们的中心放在试样所在轴或线盘轴线上。采用四个 TLD 以便于获得具有代表性的平均值。应采用等于或略大于实际试验剂量的校准系统。为保证实际试验剂量测量的最大可能的准确度，TLD 只限于使用一次。

被测光纤端面应光滑、清洁并与光纤轴垂直。

(1) 环境背景辐照试验

测量试样暴露在 γ 辐照源前后衰减变化的测量步骤如下：

- ① 将光纤或光缆试样（绕成圈或绕在线轴或线盘上）置于图 7.2 所示的试验箱中；

- ② 将光纤输入端和输出端放在定位装置上，并分别与光源和探测器对准；
- ③ 试验前，应对试样在 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ 的温箱中预处理 1h，或在该温度下按产品规范规定的时间预处理；
- ④ 按截断法，测量试样在规定波长下的衰减值，并记录暴露于 γ 辐射源之前光纤的衰减值 A_1 ；
- ⑤ 采用经校准的功率计测量试样输入端（图 7.2 中 A 点）的功率。需要时，应调节光源功率使得 A 点功率小于 $1.0\mu\text{W}$ 或按产品规范中的规定；
- ⑥ 按要求制备试样端面，并将试样端对在试验装置上；
- ⑦ 在辐射源关闭的情况下，应对试样的输入端进行定位，以便在探测器上获得最大光功率。一旦调好之后，在 γ 辐照试验期间不应改变输入端光注入条件；
- ⑧ 辐照前，应在规定的试验温度下对所有试验波长测量输出功率；
- ⑨ 将某种曲线记录仪或合适的测量装置连接到检测系统进行连续功率测量，应调整测量设备。使检测信号不超过设备的极限；
- ⑩ 通过使试样经受不大于 0.2Gy/h 的剂量率来测量由于暴露于 γ 辐照而产生的环境背景辐射效应。试样应经受至少为 1Gy 的最小总剂量；
- (11) 在 γ 辐照周期内应记录试样输出功率；
- (12) 在完成辐照过程的 2h 之内，应按截断法进行试样的衰减测量，应记录暴露于 γ 辐射源之后试样的衰减值 A_1 ；
- (13) 对要求的试验温度和波长，重复步骤①~(12)。对每一个要求的温度，必须采用新的未经辐照的试样。

(2) 有害环境试验

在暴露于 γ 辐射源前后及期间，测量试样中传输功率的程序如下所述；

- ① 按要求制备短段试样 (1 ~ 2m) 端面；
- ② 将短段试样输入端置于定位装置上并与试验装置对准（见图 7.3），使得用经校准的功率计测量时获得最大光功率。需要时，应采用中性密度滤波器调节光源功率，以在短段试样输出端获得不大于 $1.0\mu\text{W}$ 或按产品规范规定的光功率；
- ③ 将试样轴放于试验装置中，如图 7.3 所示；
- ④ 应将试样输入端置于定位装置上并进行对准，应对输出端进行定位以使从试样出射的全部光入射到探测器光敏面上；
- ⑤ 试验前，应对试样在 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ 温度箱内预处理 1h；
- ⑥ 辐射源关闭后，应对试样输入端进行定位，以在探测器上获得最大光功率。一旦调好后，在 γ 辐照期间，不应改变输入端注入条件；
- ⑦ 辐照前，应在规定的试验温度下，在所有的试验波长测量输出功率。这时还应测量参考探测器功率；
- ⑧ 应将某种曲线记录仪或合适的连续测量装置连接到检测系统，以便进行

连续功率测量。应调整测量设备以使检测信号不超过设备极限；

⑨ 通过使试样至少经受表 7.2 规定的剂量率和总剂量大小组合之一来测定由于暴露于 γ 辐照而产生的有害效应。

表 7.2 总剂量/剂量率组合

总剂量 Gy (Sievert)	剂量率 Gy/s
30	0.05
100	0.5
1000	2
10000	2

因为辐射源特性变化，剂量率大小仅是近似值。辐射源之间剂量率的变化预计高达 $\pm 50\%$ ，打开或关闭辐射源所需的时间应不大于总暴露时间的 10% ；

(10) 在 γ 辐照周期内记录试样输出功率，在完成辐照过程后至少还要记录功率 15min 或按产品规范规定。在完成辐照过程之后的恢复期内，还应记录参考检测功率大小；

(11) 对要求的试验温度和波长，重复步骤②~(10)。对每一个要求的温度，必须采用新的未经辐照的试样。

(3) 计算

① 光衰减变化 ΔA (环境背景辐照试验)

$$\Delta A = A_2 - A_1 \quad (7.7)$$

式中： A_1 —暴露于 γ 辐照之前试样的衰减 (dB)；

A_2 —暴露于 γ 辐照之后试样的衰减 (dB)。

② 每一波长下光透射率变化 A (有害环境试验)

$$A_0 = -10 \lg(P_0/P_B) \quad (7.8)$$

$$A_{15} = -10 \lg(P_{15}/P_B) \quad (7.9)$$

式中： P_0 —停止辐照 1s 内试样的功率输出 (除非另有规定) (mW)；

P_{15} —停止辐照 15min 内试样的功率输出 (除非另有规定) (μW)；

P_B —辐照开始前试样的功率输出 (μW)；

A_0 —紧接辐照之后试样的光透射率变化 (光衰减) (dB)；

A_{15} —辐照后 15min 内试样的光透射率变化 (光衰减) (dB)。

③ 考虑到系统的不稳定性，采用参考测量时，参考探测器的测量结果为：

$$A_{\text{REF}} = -10 \lg(P_E/P_{\text{BN}}) \quad (7.10)$$

式中： P_E —测量结束时由参考探测器测得的功率 (μW)；

P_{BN} —辐照开始前由参考探测器测得的功率 (μW)。

④ 考虑系统不稳定,修正后的试验结果为:

$$A_{0\text{NOR}}=A_0-A_{\text{REF}} \quad (7.11)$$

$$A_{15\text{NOR}}=A_{15}-A_{\text{REF}} \quad (7.12)$$

第八章 光纤机械性能测试

第一节 光缆机械性能测试的目的

光缆机械性能试验是指检验光缆产品所具有的抗外部机械力作用能力的试验。光缆在制造、运输、施工和使用过程中都会受到各种外机械力作用。光缆在外机械力作用下。光缆中光纤很可能会受到外机械力作用,其传输性能可能发生变化,使用寿命有可能缩短,甚至出现断纤现象。光缆的机械性能技术指标是光缆产品质量的重要技术指标。光缆机械性能检测设备是检验光缆产品机械性能的设备。

光缆在制造、运输、施工和使用中通常受到综合型的外机械力作用,不同情况下光缆承受的外作用力不但大小不同,而且类型也不同。综合各种受力状态,可分解为:拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、曲绕、卷绕和振动等八种典型的受力状态。

光缆机械性能试验是检验光缆产品机械性能是否达到企业标准或者订货合同技术指标要求的检测试验,即判断被检测光缆产品是否合格的试验,光缆厂要定期按本厂企业标准对所生产的各种型号光缆做这种常规试验,以便及时判断所生产的光缆产品质量及质量控制是否存在问题。

第二节 性能测试

本章介绍的各种光缆机械性能测试方法,应根据光缆类型由用户与厂家共同商定。不同的光缆类型应选择不同的试验项目,并非所有的光缆类型都要做所有的项目。合格判据和试样数量等应符合相关的国家标准、行业标准和产品进网规定。

一、拉伸

1. 目的

拉伸的测试方法适用于在规定的拉力下试验光缆,以验证在敷设的光缆中光纤的衰减和光纤伸长应变性能与负载之间的关系。这个方法的初衷是非破坏性的

(即施加的拉伸力应在光缆的弹性范围内)。

两种测试方法为：

方法 1：测量衰减变化的方法。

方法 2：确定光纤伸长应变的方法。

方法 2 可以提供现场敷设光缆最大允许拉力和光缆应变安全系数。两个方法既可单独使用，也可以组合使用，应按详细规范要求或按用户和厂方协商意见进行。

2. 试样

试样应在整盘光缆上进行。在受试光缆的两端做好光纤端面处理。

3. 试验装置

试验装置组成的示例，如图 8.1 和图 8.2 所示。

(1) 方法 1：用一台衰减测量仪来测量衰减变化

(2) 方法 2：用一台光纤伸长应变测量仪（详见光纤伸长测量方法）测量其拉伸应变。抗拉强度测量装置能够调节受试光缆的最小长度。所用的转向滑轮，如图 8.2 所示。

负载传感器的最大负载范围的最大误差为 3%。仔细地按规定方法调节夹持装置来夹持光缆使之不影响试验结果。如需要，应提供机械和电气方法来测量光缆伸长。

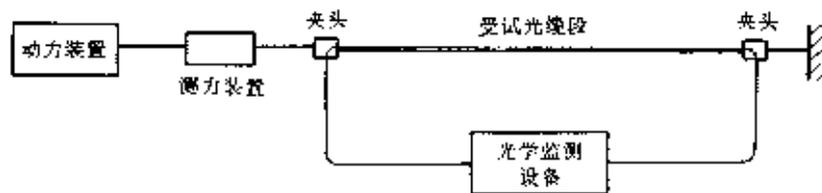


图 8.1 拉伸性能测量原理

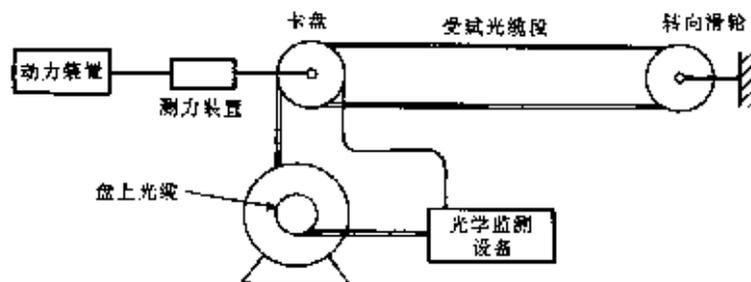


图 8.2 用转向滑轮和卡盘的拉伸试验装置示例

4. 试验程序

试验应在标准大气条件下进行。安装光缆至拉伸设备并保证其固定安全。在

拉伸设备和两端所用的固定光缆的方法是均匀地固定受试光缆，限定住光缆中的所有元件的移动。对多层光缆结构（例如，层绞式光缆），实际上是夹持住光缆各元件（除光纤外），足以获得衰减变化和/或光缆的最大允许拉伸负载和应变极限。然而，对某些光缆结构（如中心管式）需要通过防止光纤滑动措施才能获得正确的应变极限值。

将拉伸试验中光缆的光纤连接到测量仪。对方法 2（光纤伸长测量方法一差分脉冲时延），在试样拉伸中要小心不要让标准光纤长度发生变化。

按有关规范要求连续增大拉伸负载至规定值。记录衰减变化和/或光纤应变与光缆负载或伸长的函数关系。对大芯数光缆，可以采用一台多路衰减和（或）多路光纤应变测量仪。通常，试验循环次数为一次。

试样的衰减和/或光纤应变不超过相关规范的要求值。对方法 2 如果有详细的规范要求，应该计算出光纤伸长率与负载，包括去除拉伸负荷后的残留伸长。光缆伸长率 ε_c 和光纤伸长率 ε_f ，如图 8.3 所示。

如果需要，应在光纤应变与拉伸负荷曲线上定义出光纤开始发生应变处的负荷，即曲线的线性部分与负荷横坐标轴的相交点。试验报告中应包括下列内容：光缆长度和受试长度、光纤端面制备状况、负荷传感器、注入条件、衰减测量仪用的光纤应变测量装置、在特定波长的衰减或光纤应变变化与负荷的函数关系及拉伸速率等。

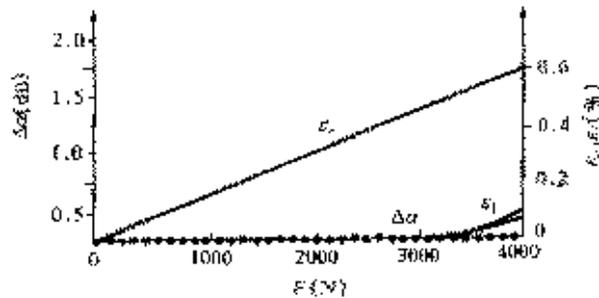


图 8.3 光纤伸长和光缆伸长与拉伸负荷的函数关系

二、光缆护套耐磨损

1. 目的

光缆耐磨损包括两个涵义：护套的耐磨损和光缆标志的耐磨损。本书光缆耐磨损试验的目的是确定光缆护套耐磨损。

2. 试样

试样长度按规定要求，典型的试样长度为 750mm。

3. 试验装置

耐磨损试验装置是由一个设计成沿平行光缆纵轴从两个方向以每分钟 55 ± 5 个循环的频率磨擦光缆外表面的长度为 $10 \pm 1\text{mm}$ 的设备组成。一个磨擦沿两个

方向各移动一次构成一个磨损循环。磨擦刃口应是直径为按详细规范规定的一个钢针。一个典型的磨损试验装置，如图 8.4 所示。

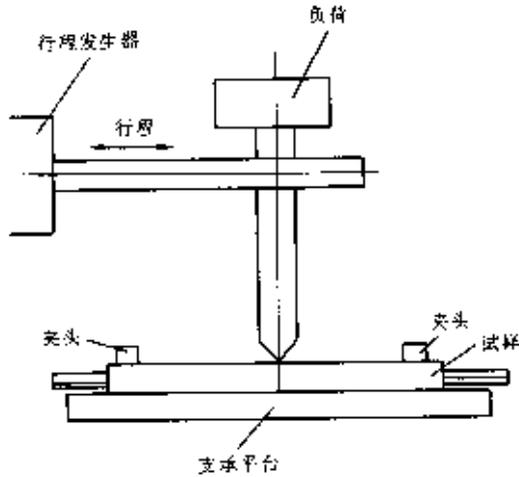


图 8.4 磨损试验装置

4. 试验程序

试验应在标准大气条件下进行。用光缆夹头将测量长度大约为 750mm 的光缆试样牢牢地固定在支撑平台上。按有关规范要求给磨擦刃口提供所需的负荷力，而且要避免冲击光缆。对每个试样进行四次试验，每次试验后试样向前移动 100mm，同时按同一方向旋转 90°。

按有关规范要求的循环数试验后，光缆护套应无磨穿现象出现，而且要保持光缆中光纤的光学连续性。

三、压扁

1. 目的

压扁试验的目的是验证光缆的耐压能力。

2. 试样

光缆试样长度要保证完成试验规定的要求。

3. 试验装置

试验装置应能使在平钢板和可移动钢板之间的光缆试样的受试长度为 100mm 的部分受到均匀的压力。可移动钢板的边缘应倒圆，倒圆的半径大约为 5mm。在钢板的平面部分不包括边缘。典型的试验装置如图 8.5 所示。

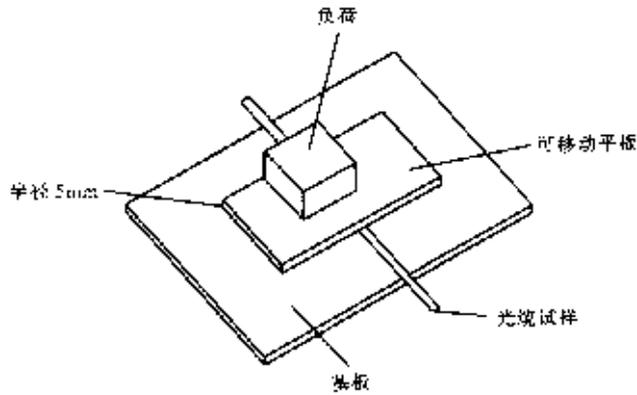


图 8.5 压扁试验装置

4. 试验程序

将光缆试样置于两平钢板间，防止其侧向移动。逐渐施加压力，以求不产生突然变化。如采用逐步增量方式施加压力，则增量比不超过 1.5:1。

在不转动光缆试样的情况下，压力应施加在试样的三个不同的位置，它们的位置间隔应大于 500mm。

如有规范要求进行工作条件试验，可在垂直于试样方向插入一根或多根钢棒（直径为 25mm）进行附加或替代试验。试验应在标准大气压下进行，试验时应在有关规范中规定最大压扁力、允许的短暂压扁力和长期压扁力。通常，试验施加负荷的持续时间至少为 1min。如有要求应在加载下测量试样的附加衰减，卸载 5min 后，测量试样衰减变化。

试验合格判断依据应详细规定。典型的破坏形式包括：光缆中光纤丧失光学连续性，光传输性能恶化或光缆遭受到物理损伤。

图 8.6 所示为典型的压扁试验中测量的压扁力与附加衰减的变化曲线。

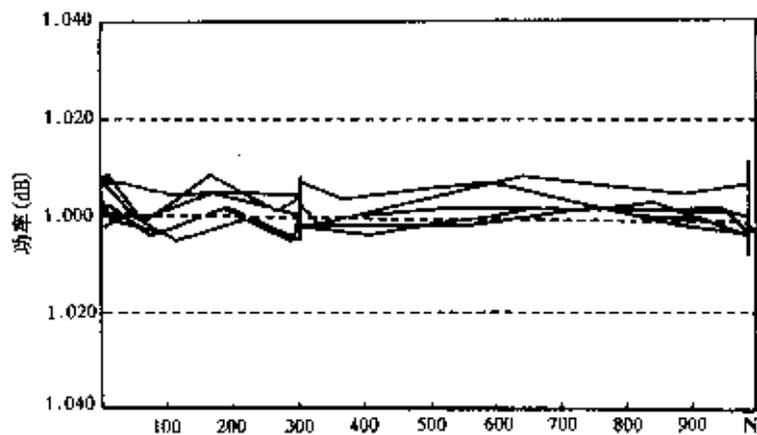


图 8.6 压扁力与附加衰减的变化曲线

四、冲击

1. 目的

冲击试验的目的是验证光缆耐冲击能力。

2. 试样

光缆试样长度要保证完成试验规定的要求，当只对光缆试样物理损坏进行判定时，试样长度为 1m（如小直径的软跳线光缆或双芯光缆）至 5m（大直径光缆）。如要进行光缆光学性能测量时则要求的光缆试样长度较长。

光缆试样和每端连接一个连接器或者采用一种典型的方法，将光纤、护套和加强件夹持在一起，如冲击装置上的夹具合适，试样就不受上述限制。

3. 试验装置

试验装置将使冲击作用到固定在一个钢基座平台上的光缆试样上。对只需一次或几次冲击的试验，所选用的合适试验装置，如图 8.7 所示。

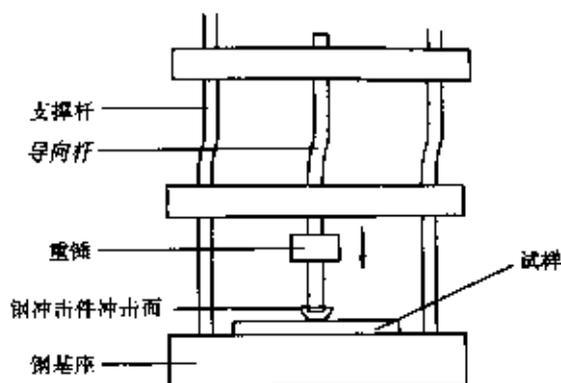


图 8.7 几次冲击试验装置

冲击试验装置将重物以垂直落体方式使冲击力传递到受试光缆试样的一个中间钢件上。当需要进行重复冲击（即冲击数大于 5 次）试验时，选用的是更为实用的冲击试验装置，如图 8.8 所示。通过落锤可实现重复冲击。通常，冲击速率约为 2 秒一个循环。

与试样接触的冲击表面应为圆形。它即可是半球形（图 8.9A）又可是圆柱形（图 8.9B）。冲击件表面半径 R 应为 300mm。试验装置应包括光学性能测试设备，按规范要求对试样进行衰减变化的测量。

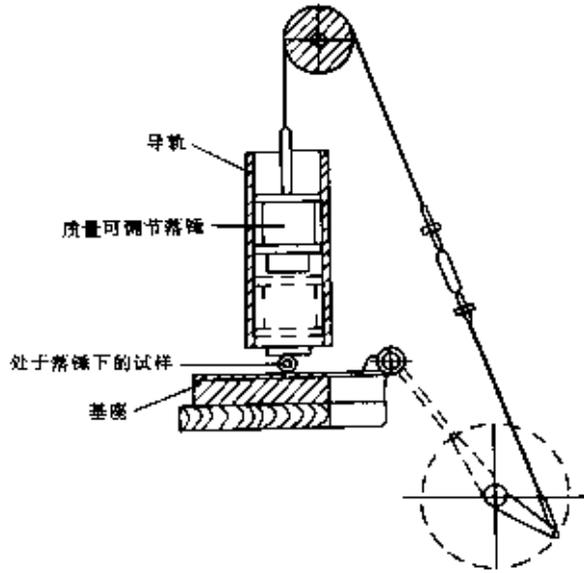


图 8.8 重复冲击试验装置

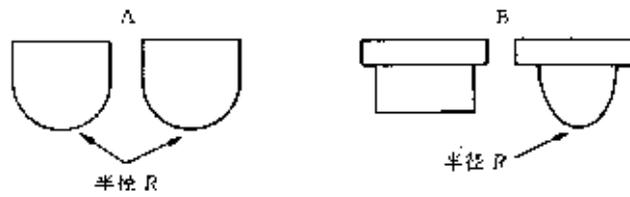


图 8.9 冲击件表面形状

4. 试验程序

试验是在标准大气压条件下进行。如需要，光缆试样应在标准大气压条件下预处理 24h。冲击试验规范中应规定冲击次数、冲击速率和在试样上的冲击位置。

试验合格判据应按有关规范内容进行。典型的试样失效形式包括：光缆中光纤丧失光学连续性、光传输性能降低或光缆物理损伤、图 8.10 给出一个典型的冲击试验引起光纤附加衰减的曲线。

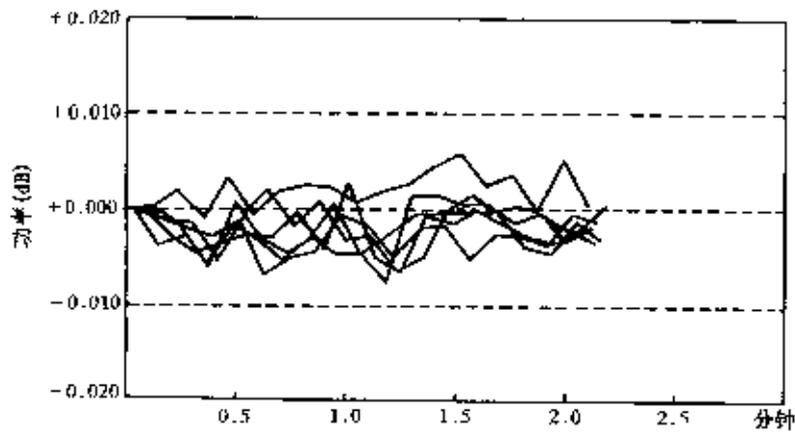


图 8.10 冲击试验的光纤附加衰减

五、反复弯曲

1. 目的

反复弯曲试验的目的是验证光缆经受反复弯曲的能力。

2. 试样

试样长度应满足试验规定的要求。当只鉴别光缆试样物理损伤时，试样长度为 1m（例如，小直径的软跳线光缆或双芯光缆）至 5m（如大直径光缆）。如要进行光学性能测量时，所需要的试样长度会更长。

光缆试样的每端应与连接器连接，或以一种典型的方法将光纤、护套和加强件夹持在一起。如果弯曲装置上的夹具合适，试样长度不受上述条件限制。

3. 试验装置

试验装置允许试样左右往复弯曲角度达 180° 。试样的两个极根位置为试样的两个垂直边弯成 90° 。与此同时，试样受到一个拉伸负荷。光缆反复弯曲试验装置，如图 8.11 所示。对带有连接器的光缆反复弯曲试验装置，如图 8.12 所示。

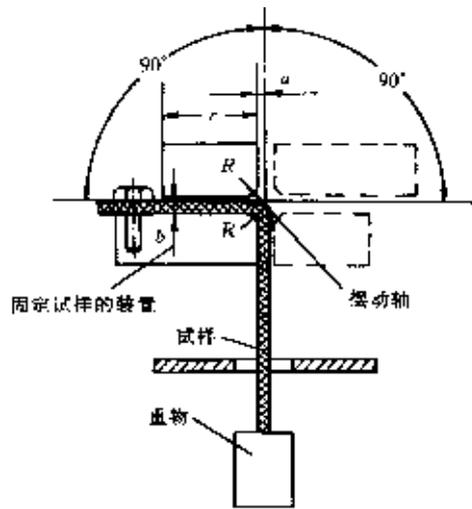


图 8.11 光缆反复弯曲试验装置

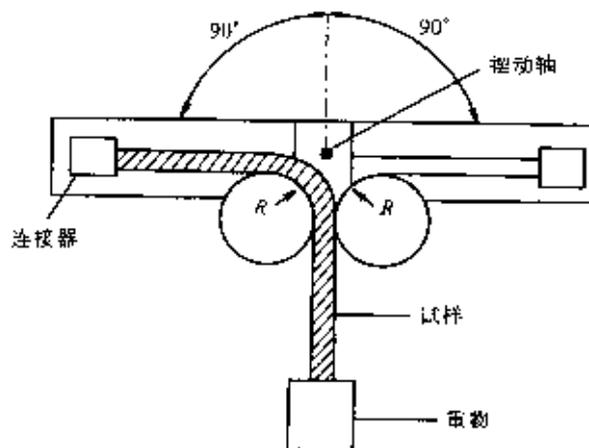


图 8.12 带连接器的光缆反复弯曲试验装置

试验装置应具有一可调节的夹具或固定件来牢牢地夹住光缆试样，以求试验中不压住光纤或引起光衰减。对带有连接器的光缆，可用连接器将试样光缆固定到弯曲臂上。

试验装置应具有循环能力，将试样由垂直位置移至右端极限位置。然后摆动弯曲到左端极限位置，再返回到原始的垂直位置构成一个循环。通常，弯曲速率为 2 秒一个循环。如有必要，试验装置应包括光传输性能测试设备来测量受试光缆中光纤的光衰减变化。

4. 试验程序

试验应在标准大气压条件下进行，试验程序分为六个步骤实施。

- (1) 将光缆试样在标准大气压下预处理 24h;
- (2) 将试样固定在试验装置上，方法如图 8.11 和图 8.12 所示;
- (3) 按规范要求对试样施加重物;
- (4) 建立测量合格判据的基准值;
- (5) 按规范规定的循环次数进行反复弯曲;
- (6) 进行合格判据参数测量，如需要，将试样从试验装置上取下进行外观检查。

试验合格判据应在规范要求内，典型的试验失效形式包括：受试光缆中光纤丧失光学连接性、光传输性能下降或光缆受到物理损伤。

六、扭转

1. 目的

扭转试验旨在确定光缆抗机械扭转的能力。本试验的目的一是当光缆护套受到扭转外力作用时，测量光纤的光功率变化；二是判定当扭转外力作用时，光缆发生物理损伤的可能性。

2. 试样

光缆试样的总长度应确保其夹持和扭转要求,且能满足按规范要求传输性能测量的长度。

3. 试验装置

扭转试验装置主要由两个光缆夹头组成。一个固定夹头和一个转动夹头作为夹持用。两个夹头之间的距离是可调的。转动夹头与合适的转动装置(如一扭转柄)相连接。所用的夹头支架、夹具或扭转装置应允许与光缆试样两端相连接,以便进行必要的传输性能试验。一些典型的光缆扭转试验装置,如图 8.13、图 8.14、图 8.15 所示。

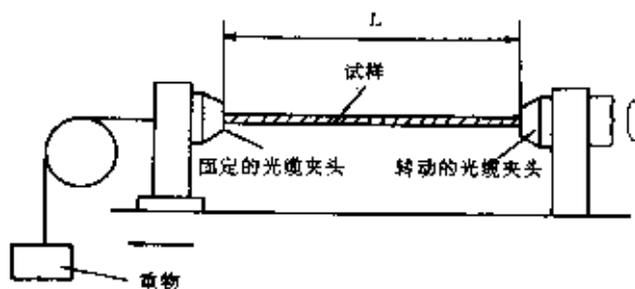


图 8.13 光缆扭转试验装置

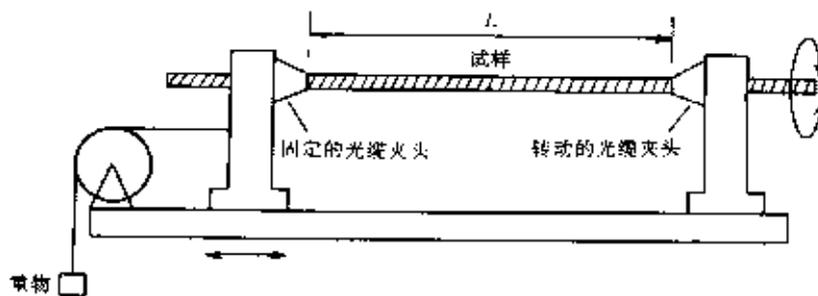


图 8.14 施加拉伸力的光缆扭转试验装置

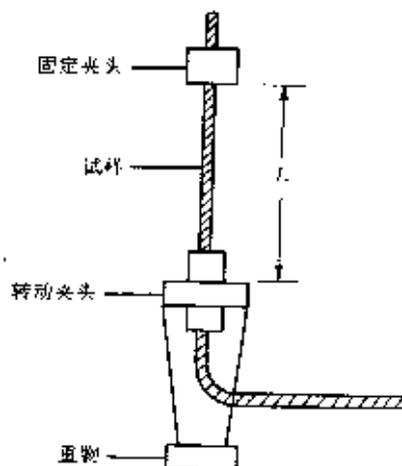


图 8.15 施加拉伸的替代光缆扭转试验装置

光缆夹头应具有下列功能：

- (1) 夹头应紧紧夹住光缆周围，以防止光缆在夹头中移动。
- (2) 夹头牢固地夹持光缆呈直线。
- (3) 夹头既不会由夹头内缘对光缆产生局部扭转损伤，又不会在光缆上造成压力局部集中。
- (4) 夹持过程中不会使试样中产生任何明显或精确到可测的衰减增加。

如果规范要求试样由弯曲变直，在夹头处加上重物或合适的负载装置使光缆受到拉伸负荷，详见图 8.14 和图 8.15 所示。

正如具体规范要求，试验装置包括光传输性能测量设备来测量整个测试过程中光缆中光纤的光传输性能变化。

4. 试验程序

夹在试验装置中的试样受试长度应满足具体规范要求。小心确保试样不受到初始应力，除非需要进行扭转操作外，在整个试验中注意不要移动或扰动两端。尽最大可能减小试样垂度（图 8.13 和图 8.14）或与直线的垂直偏差（图 8.15）。如果具体规范要求测量光传输性能变化，所测的试样应不受力，比较夹持后的测量结果，以保证夹持不会明显地降低光缆光传输性能。

除非另有要求，通过支撑试验长度或对处在两夹头之间光缆试样施加拉力使试样垂度和弯曲得更小。如需要，按具体规范的要求施加拉力使试样呈直线状。施加拉力的数值，如表 8.1 所列。

表 8.1 施加的拉力

标称光缆直径范围	mm	最小负载	N
≤ 2.5		15	
2.6 ~ 4.0		25	
4.1 ~ 6.0		40	
6.1 ~ 9.0		45	
9.1 ~ 13.0		50	
13.1 ~ 18.0		55	
18.1 ~ 24.0		65	
24.1 ~ 30.0		70	
≥ 30.1		75	

如具体试验规范要求测定光传输性能变化，应在光缆试样夹好且施加拉力负载后测量试样光缆中光纤的光输出功率。

旋转活动夹头的方法如下：顺时针旋转 180° 返回起始位置，反时针旋转 180°

° 返回起始位置。四个旋转运动构成一个循环。除非另有规定，每个循环应在 1min 内完成，总的循环数为 10。

在最后一个（即第十个）循环过程中，为确定光缆中传输光纤数要使试样光缆顺时针旋转 180°，反时针旋转 180° 在最后一个循环完成后，光缆不转动。

完成合格判据参数测量。让试样至少静止 5min。如果需要，将试样从试验装置上取下进行目视检查。

被测试样的合格判据应在具体的规范中予以阐述。典型的损伤形式为：丧失光学连续性、光纤损耗增加和光缆护套组件损坏。

七、曲挠

1. 目的

曲挠试验的目的是确定光缆在服役（如电梯光缆）中耐反复曲挠的能力。

2. 试样

试样应终接在一连接器的两端或以一种典型的方式将光纤、护套和加强件夹持在一起。试样长度应满足完成试验的规定要求。

3. 试验装置

曲挠试验所用的试验装置，如图 8.16 所示。装置中的各滑轮，对圆形光缆，滑轮凹槽为半圆形；对扁平形光缆，滑轮凹槽为扁平形。固定限位夹头，通过拖架往复移动由拖架上的重物来始终对试样施加拉伸。

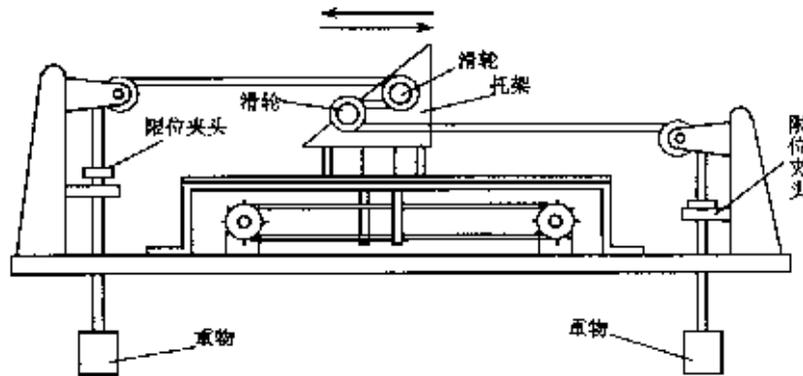


图 8.16 曲挠试验装置

4. 试验程序

试验后在标准大气压条件下进行。试样应通过滑轮拉紧。试样每端都加载重物。重物的质量和滑轮的直径应在规范中规定。应具体规定要求的循环次数，对光缆试样进行曲挠。一个循环的定义为：拖架离开起始位置移动到往复运动一端，再反向移动到往复运动的另一端回到起始位置。

在有关规定中应对试验的合格判据提出要求。典型损坏形式包括：丧失光学连续性、光传输性能降低或光缆物理损伤。

试验规范中应规定出：滑轮的直径、重物质量和循环次数。

八、弯折

1. 目的

弯折试验的目的是确定光缆由弯折成一个圈开始缩小至最小圈的直径。

2. 试样

试样光缆长度应满足试验规定的要求。

3. 试验装置

试验如图 8.17 所示。即无需具体的试验装置。

4. 试验程序

按图 8.17 所示(1)。双手将试样光缆弯成一个圈，按图 8.17 所示(2)慢慢拉光缆试样两端使弯折圈直径开始缩小。位于弯折圈底部的力应作用在同一平面上。

试验应在标准大气条件下进行。图 8.17 所示(3)为弯折出现。

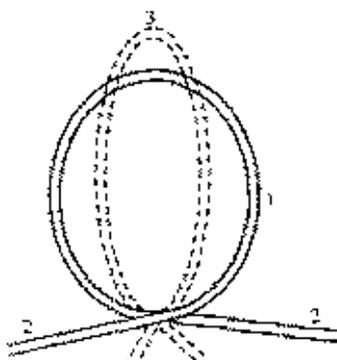


图 8.17 弯折试验

九、弯曲

1. 目的

弯曲试验的目的是确定光缆或光缆元件耐围绕试验圆柱心轴弯曲的能力。

2. 试样

试样的两端应进行端接，典型的方法是将光纤、护套和加强件夹在一起。

3. 试验装置

一个圆柱心轴装置能使试样围绕圆柱心轴切向密密地缠绕成螺旋状。

4. 试验程序

可从下述的两个试验程序中任选一个进行试验。每个试验程序的具体规范分述如下：

(1) 试验程序 1

试样应以均匀速率围绕圆柱心轴切向密密地缠绕成螺旋状。施加足够的张力

来确保试样紧紧缠绕到圆柱心轴外表面，然后退绕。一次缠绕和一次退绕就组成一个循环。

试验圆柱心轴直径、每个试验的螺旋圈数和循环次数在具体规范中列出。

(2) 试验程序 2

试样应绕试验圆心轴弯曲 180° 。弯曲时试样应保持在拉紧状态。一个弯曲循环是由一个 U 形弯曲紧接着一个反向 U 形弯曲。再返回到半径状组成。试验圆心轴直径和循环次数应在具体规范中列出。

试验合格判据应在具体规范中列出。典型的损坏形式包括：丧失光学连续性、光传输性能下降或光缆物理损坏。

十、耐切入

1. 目的

耐切入试验方法的目的是确定光缆（如航空光缆）护套耐切入性能。

2. 试样

试样长度应满足试验规定要求。

3. 试验装置

所设计的试验装置应能以规定的速率对试样施加要求的切入力。适用的典型试验装置，如图 8.18 所示。应详细规范针棒的半径。

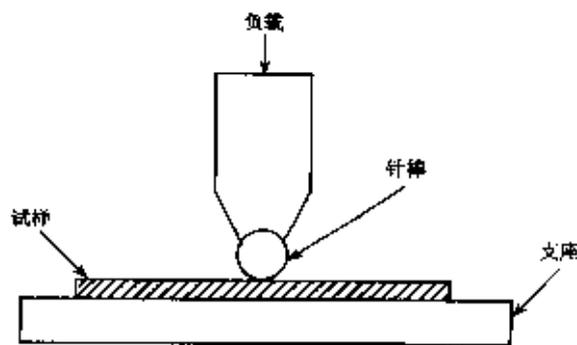


图 8.18 切入试验装置

4. 试验程序

试验时，以 $50 \pm 10\text{N/min}$ 的速率逐渐地将切入力施加到试样上，所施切入力直至规范要求值。切入力持续作用时间应达到试验要求的时间。

试验结束后，用 5 倍和 10 倍放大镜目力观察试样是否遭受任何损伤。判断受试光缆合格与否的条件为：试样光缆护层上观察不到贯穿，而且试样光缆保持着光学连续性。

十一、枪击损伤

1. 目的

枪击损伤试验的目的是确定架空光缆耐猎枪枪击的损伤能力。

2. 试样

所用的光缆试样的典型长度为 3m。

3. 试验装置

枪击损伤试验的试验装置由枪和光缆试样组成。有关枪击损伤试验的试验条件为：

(1) 按规定要求规定枪型，枪型各国差别很大；

(2) 夹持光缆试样的支架应能使试样自由摆动。试验装置也应考虑与所用的枪有关的枪弹以椭圆形式散射击中试样；

(3) 子弹尺寸差别很大。它应该代表着实际安装光缆遭受枪击危险的情况。应具体规定子弹头类型。常用的弹头为铅或钢，与国别和厂家有关。铅弹头易冲击变形，其破坏性小于钢弹头。应对弹壳提出具体的规范要求。

4. 试验程序

将光缆试样安装在支架上，按规范要求的距离射击，典型的射击距离为 20m。可见弹着点数少，典型的为 3 个或更少。如光缆上弹着点数超过 3 个，应重新进行枪击试验。经过枪击试验后的光缆试样中的光纤仍应保持光学连续性。

十二、刚性

1. 目的

刚性试验的目的是测量光缆的刚性。通常可按光缆的类型从三个试验方法中任选一个进行光缆的刚性试验。

刚性是评价采用常用的拉放技术敷设（例如，管道、导管或地毯下）和吹气技术敷设时的光缆刚性，刚性也用于确保跳线光缆和室内光缆经受严重弯曲仍能进行敷设和正常使用的性能。在此应指出的是，由下述的三个试验方法测得的光缆刚性值与用其他试验方法确定的值并不相等。

2. 试样

光缆刚性试验按光缆类型不同可分为 A、B、C 三种方法，方法 A 和方法 B 适用于大直径光缆，方法 B 也适用于小直径光缆，包括：轻型铠装光缆和室内光缆。有关三种试验方法中涉及到的试样、试验装置、试验程序等内容，如下所述：

(1) 试验方法 A

① 试样

试样长度应满足试验规定的要求。

② 试验装置

三点弯曲试验装置，如图 8.19 所示。将光缆试样放置在允许试样光缆自由运行的两个支撑件上（例如用可旋转的棒作为支撑件）。试验装置应能对放在两个支撑件之间的试样施加作用力，并能测量受力后光缆试样发生的位移。

③ 试验程序

按具体规范要求确定两个支撑件分开的距离。先将试样光缆放在两个支撑件上，再对试样施加作用力，最后测量光缆试样受力后发生的位移。

试样光缆长度超过两个支撑件距离，以此来保证光缆各组成件的任何内部的移动都不会影响测量结果。

作用力是通过固定到拉力试验机上的一个刀片或一个钩到光缆上的重物施加上到光缆试样上的。

如果作用力为 $F(N)$ 引起试样光缆产生的位移为 $Y(m)$ ，两个支撑件之间的距离为 $X(m)$ ，那么光缆的刚性 B 为：

$$B = \frac{X^3(m)F(N)}{48y(m)} \quad (N \cdot m) \quad (8.1)$$

由于有些光缆（如铠装光缆）受到力作用后会呈现出一个由弹性状态到非弹性状态的变化特点，如图 8.20 所示。所规定的刚性是弹性刚性为：

$$B = \frac{X^3(m)}{48} \tan \alpha \quad (N \cdot m) \quad (8.2)$$

式中： α 为曲线线性部分与横座标之间的夹角。

光缆刚性应满足规范中规定的要求。

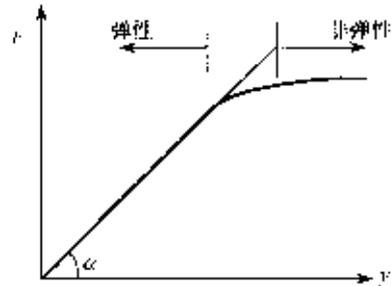
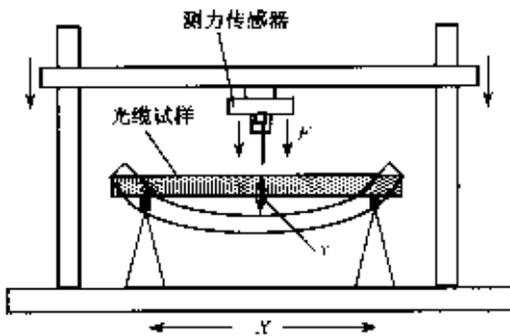


图 8.19 试验方法 A 的试验装置 图 8.20 力作用后引起光缆的位移变化的特点

(2) 试验方法 B

① 试样

试样长度应满足试验规定的要求。

② 试验装置

悬臂试验装置，如图 8.21 所示。先将光缆试样牢牢地固定在一个夹具中，再借助试验装置对远离夹具的试样端施加一个作用力，最后测量受力后光缆发生的位移。在有些情况下（如小直径的跳线光缆），夹具设计成能够控制试样的弯曲半径。

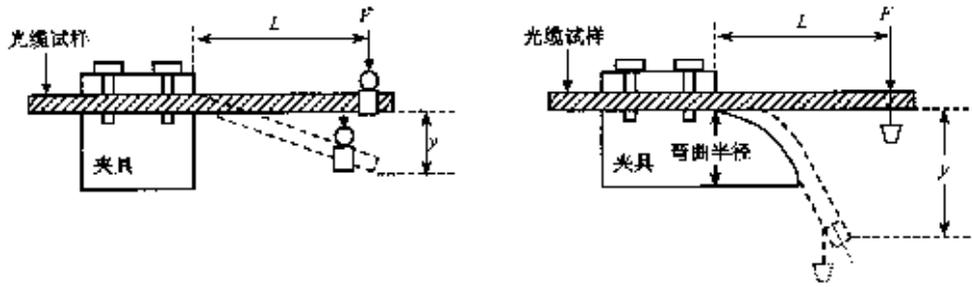


图 8.21 试验方法 B 的试验装置

③ 试验程序

先将光缆试样牢牢地固定在夹具中，再在离开夹具距离为 L 的试样处施加一作用力，最后测量受力后光缆发生的位移。

作用力是由拉力试验机或重物提供的。所选的试样长度应能保证光缆各组成件任何内部移动都不会影响测量结果。如一作用力 F (N) 引起光缆产生的位移为 Y (m)，试样光缆悬跨长度为 L (m)，那么光缆的刚性为：

$$B = \frac{L^3 F}{3y} \quad \text{或} \quad B = \frac{L^3}{3} \tan \alpha \quad (\text{N} \cdot \text{m}^2) \quad (8.11)$$

式中： α 为弯曲角。

光缆刚性应满足详细的技术规范要求。

(3) 试验方法 C

① 试样

试样长度应满足试验规定的要求。

② 试验装置

试验装置，如图 8.22 所示。试验装置应提供一种测定试样光缆 U 形弯曲时作用在试样上的力的方法。适宜的试验装置是一台配置有压力传感器和在规定的试验过程中具有维持给定的夹片间距的拉力试验机。

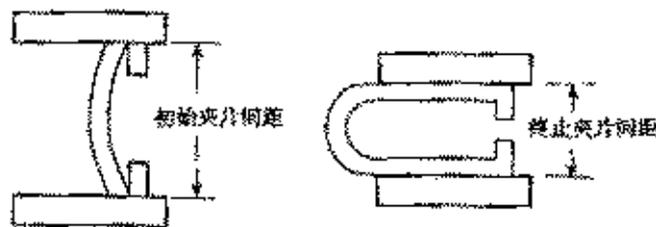


图 8.22 试验方法 C 的试验装置

③ 试验程序

试样以平直状态放入试验装置中。减小夹片间距到由 $S \cdot d$ 给定的值。 d 为光缆直径， S 是具体规范要求的间距因子。在按具体规范要求的试验时间作用后，

记录作用在试样上的力。光缆的刚性为：

$$B = F \pi r^2 \quad (\text{N} \cdot \text{m}^2) \quad (8.4)$$

式中：F—测得的力(N)；

r—最终的夹片间距的试样光纤的弯曲半径。

光缆刚性应满足详细的技术规范要求。

十三、拉力弯曲

1. 目的

拉力弯曲试验是一个对光缆进行的动态试验，其目的是通过对试样光缆施加特定的负荷来确定光缆耐绕滚轮的弯曲或敷设中的弯曲的能力。

2. 试样

试样是从成品光缆一端抽出。按规范要求不要剪断。试样光缆两端应进行端接。端接的方法应便于对试样施加规定的负荷。试样光缆上应标出A点和B点，标注方式，分别如图8.23和图8.24所示。

3. 试验装置

试验装置是由一台最大误差为 $\pm 3\%$ 的拉力驱动装置组成。如特殊用户需要，试验装置还应配置一台衰减测量仪来测定衰减变化和/或一台光纤拉伸应变测试仪。

拉力弯曲试验有两种试验方法：U形弯曲试验和S形弯曲试验。U形弯曲试验装置，如图8.23所示。在相关的试验规范中应给出图中滚轮的半径r。S形弯曲试验装置，如图8.24所示。在相关的试验规范中应给定两个滚轮的半径r，两个滚轮的间距Y和弯曲角 ϕ 。

4. 试验程序

试验应在室温下进行。按具体技术规范中规定的要求，测量和记录施加规定负荷前和试验后负荷为零时的衰减变化。根据敷设方法和具体规范要求，可从下述的两个试验程序中任选一个进行试验。

(1) U形弯曲试验程序

光缆应绕一个圆筒形成一个最小的弯曲 180° （U形弯曲），如图8.23所示。或者是用户与制造厂家共同商定的其它值。拉力连续地增大到具体规范给出的要求值。光缆从A点移动到B点。再返回到A点，具体规范中应规定出移动速度和循环次数。

(2) S形弯曲试验程序

光缆绕两个圆筒形成一个S形（S形弯曲），如图8.24所示。拉力连续地增大到具体规范的要求值。光缆从A点移动到B点，再返回到A点，具体规范中应规定移动速度和循环次数。

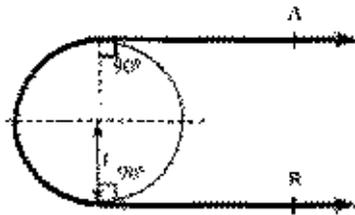


图 8.23 U形弯曲

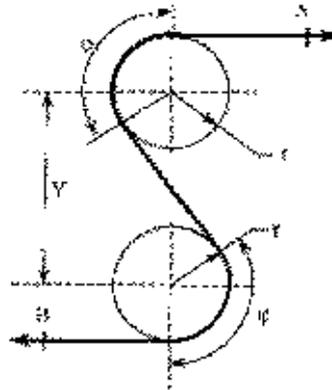


图 8.24 S形弯曲

经过拉力弯曲试验后，光缆护层和/或光缆组成元件无目力可见的损坏。拉力弯曲试验后，光缆中的光纤永久性衰减增大应不超过规范中的规定。

第九章 光缆的环境性能

第一节 环境性能测试的目的

光纤的光传输理论和物理特性与传统的金属导体有所不同，但光缆结构的基本要求与传统的金属通信电缆相同，即在光缆的生产、敷设和使用环境中保持光传输性能、环境性能、机械强度、电气性能的长期稳定。

由于通信光缆敷设到实际线路的路由上，它们会遇到各种不利的自然环境条件的作用或人为因素的影响，因此，人们应该在深入研究光缆的温度衰减、渗水、油膏滴流与蒸发、风积振动、过滑轮、舞动、耐电痕、阻燃性能的基础上，设计和制造出能够胜任任何可能面临的环境条件的光缆。换言之，实际使用的光缆应按其使用的环境要求分别具有良好的温度衰减性能、足够的机械强度、阻止水的渗透、耐电痕、阻燃等性能。总之，光缆结构的选择必须适应其使用的环境条件要求。

光缆环境性能测量的目的是模仿光缆实际使用条件，测量高低温度变化引起的光缆中光纤的附加损耗，光缆纵向、横向水渗透与否、阻水油膏高温下滴落和蒸发量、光缆受外力作用后光纤的衰减变化和光缆或光纤应变的大小，以及在感应电场和燃烧环境中光缆是否耐电痕、阻燃程度高低，以求使我们设计和制造出光缆完全适用于各种各样的通信网络，并在实际使用环境中可保证网络的长期安

全可靠。

第二节 性能与测试

一、温度循环

1. 目的

温度循环试验方法是对光缆进行温度循环试验来确定光缆经受温度变化的衰减稳定特性。

光缆中光纤的衰减随温度的变化,通常是由于光缆加强件与各种护层之间热膨胀系数差异引起光纤弯曲和拉伸造成的。衰减与温度关系的测量试验条件应在最恶劣的温度条件下进行。

温度循环试验既可用于监视光缆在储存、运输和使用中温度变化时的特性。在选定的温度范围(通常比上述的温度范围更宽)又可检查衰减稳定性与光缆结构中光纤基本情况及有微弯情况的关系。

2. 试样

试样应为一个工厂制造长度或有关规定的满足试验要求的长度。但是,试样还应能达到衰减测量所需的精度。我们建议:多模光纤光缆,试样长度不小于1000m;单模光纤光缆,试样长度不小于2000m。

为了获得再现值,光缆试样松绕成圈或绕在光缆盘上放入气候室内。光缆弯曲半径会影响到光纤对不同的膨胀和收缩(例如光纤在光缆中的滑动)的适应能力。因此,光缆的试验条件应尽可能在正常使用条件下进行。

可能出现的问题是在热循环中试样和光缆支架(盘、筐、平板等)之间膨胀系数不同引起的实际差别。只要不满足应有作用条件,试验结果将会受到明显的影响。

影响试验结果的主要因素:试验温度条件、光缆支架的类型和材料。通常建议的内容如下:

(1) 光缆盘缠绕直径要足够大,以确保光纤能调整不同的伸长和收缩。因此,缆盘缠绕直径应大于光缆运输选定的缆盘直径值。

(2) 消除试验条件下产生的光缆膨胀(或收缩)的任何危险。实际上,我们应特别小心防止试验中光缆中的残余应力。例如,光缆试样不应紧绕在缆盘上,因为紧绕会限定低温下试样的收缩。另外多层紧绕会限制高温下试样的膨胀。

(3) 推荐采用松绕,例如大直径松绕圈、具有柔软垫层缆盘或无应力装置。若需要时,为限制受试光缆长度,允许将光缆中几根光纤连接起来,对被连接光纤进行测量。应限制连接光纤数,并将连接光纤端头置于气候室外。

3. 试验装置

试验装置是由一台适合确定衰减变化的衰减测试仪和一个能容纳试样的大小合适的气候室组成控制气候室温度,以保证在规定试验温度下温差变化在 ± 3

℃内

4. 试验程序

(1) 起始测量

试样应在环境温度下至少放置 24h 进行预处理, 对试样进行外观检查并在起始温度下测量衰减基准值。

(2) 试验

① 将处于环境温度下的试样放入具有同样温度的气候室内。

② 以合适的冷却速率, 将气候室的温度由环境温度降低至适当的低温 T_A 。

③ 待气候室温度达到稳定后, 将试样暴露到低温下停留适当的时间 t_1 。

④ 以合适的升温速度, 将气候室的温度升高至适当的高温 T_B 。

⑤ 待气候室温度达到稳定后, 将试样暴露到高温下停留适当的时间 t_1 。

⑥ 接着, 以合适的冷却速率将气候室的温度降低到环境温度值。这个试验过程就构成了一个温度循环, 如图 9.1 所示。

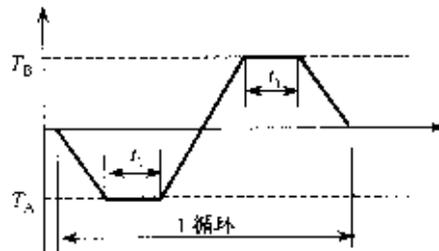


图 9.1 一个温度循环试验程序

⑦ 除非另有详细的规范要求, 光缆试样应经历两个温度循环试验。

⑧ 有关详细规范阐述的内容:

A. 试验过程中衰减变化和观察比较。

B. 在哪段时间后完成观察。

⑨ 被测试样从气候室取出之前, 应在环境温度下稳定一段时间。

⑩ 如果比较详细的规范给出的是储存和使用的不同温度范围, 而不是两个不同的试验, 则应按图 9.2 所示的组合试验程序进行试验。

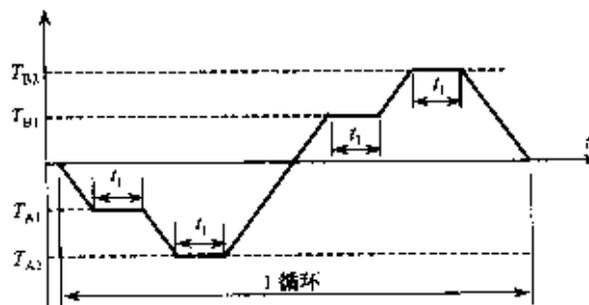


图 9.2 组合试验程序

(1) T_{A1} 、 T_{A2} 、 T_{B1} 、 T_{B2} 和 t_1 与冷却（或加热）速率应详细的规范中规定。由于光缆结构不同，缆芯的温度与气候室的温度也不同。

(3) 恢复

① 如果试样从气候室取出用于试验条件不是标准大气压条件，试样应在标准大气压条件下获得稳定的温度。

② 相关的详细技术规范中对不同类型的试样，一般都要求规定恢复周期。

有关规范中应绘出试验的合格判据。典型的损伤形式包括：光连续性损耗、光传输劣化或光缆的物理破坏。

二、渗水

1. 目的

渗水试验的目的是确定光缆在规定长度方向上阻止水迁移的能力。图 9.3 所示的两种渗水试验适用于连续的填充型阻水光缆。

通常，选用方法 A 或方法 B 之一来检查光缆渗水。方法 A 用来检验缆芯外空隙与外护层之间的水迁移。方法 B 则用来检验设计的填充型阻水光缆全横截面的水迁移。

2. 试样

(1) 方法 A

在位于光缆试样一端 3m 处去除一圈 25mm 宽的护层和绕包层，以使 1m 高的水柱的水密套筒作用在裸露的缆芯上，检验在缆芯外空隙与外来护层中形成桥接间隙的水迁移。

(2) 方法 B

受试光缆试样长度大于 1m，但不超过 3m。如果需要，试样先按弯曲试验程序进行弯曲试验，再从试样的中部截取最大光缆长度为 3m。光缆试样的一端插入水密套筒，检验 1m 高水柱对试样进行全截面水迁移作用。

3. 试验装置

两种渗水试验的试验装置分别为如图 9.3 所示。

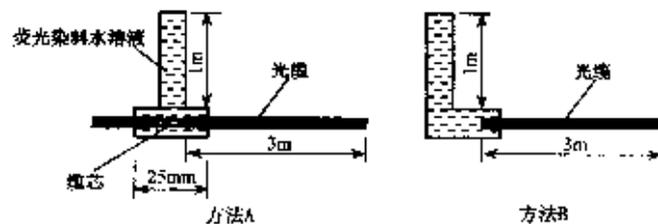


图 9.3 渗水试验

4. 试验程序

试样应水平放置，在 $20 \pm 5^\circ\text{C}$ 温度下，施加 1m 高水柱持续作用 24h。为直观清晰地检查水渗漏，通过用水溶性荧光染料或其他合适的着色剂组成溶液。所选

择的荧光染料应不与任何光缆组成元件发生化学反应。

试验裸露端应观察不到渗水。如采用的是荧光染料水溶液，则可用紫外光来进行渗水检查。

三、阻水油膏滴流

1. 目的

阻水油膏滴流试验的目的是证实填充型光缆内注入和填充的阻水油膏在规定温度下是否从光缆中滴流出来。

2. 试样

(1) 试样数和类型

除非另有规定，从每种光缆中取 5 个光缆试样进行验证试验。每个光缆试样代表着规范中规定的光缆类型。

(2) 试样长度

除非另有规定，每个试样长度应为 $300 \pm 5\text{mm}$ 。

(3) 试样制备

光缆试样制备步骤如下：

① 从试样的一端剥去一节 $130 \pm 2.5\text{mm}$ 长的外护层；

② 从试样光缆同一端去掉 $80 \pm 2.5\text{mm}$ 长的所有非光缆本征元件（如铠装、屏蔽、内护套、螺旋加强件、阻水带、其他的缆芯包带等）。不要干扰光缆的保留件（如，容纳光纤的松套管、用来保持圆形的填充物等）。

③ 轻轻地去掉经过①、②步骤后试样弄乱的粘附的一些注入或填充的阻水油膏。但要确保试样基本上保持原有的注入或填充（即不要擦干净）。

④ 如预先允许，在施加夹具、塞子（插头）之前，称量每个试样的重量。

⑤ 对包含有光纤束或光纤带的光缆结构测试时，光纤束或光纤带会因自重作用发生滑动。为确保试样未处理端的这些元件一点都不会扰动试样的填充物。用夹具、环氧树脂塞或其他方式固定光纤束和光纤带，以满足试验目的要求。

⑥ 详细规范允许时，可将松套上端密封起来达到模拟长的光缆试样的情况。

3. 试验装置

用来完成阻水油膏滴流试验的装置有：温度试验箱、盛料器皿和天平等。

(1) 温度试验箱

温度试验箱应具有足够的热容量以便在试验期间保持规定的温度，并具有足够的空间放置试样。如温度试验箱为空气环流型的，则空气不应直接吹到试样上。

(2) 盛料器皿

收集滴流物的盛料器皿应是非吸湿性容器。

(3) 天平

天平精度应至少为 0.001g ，并且能称出空的和滴有允许量的滴落物盛料器

皿间的重量差。

4. 试验程序

阻水油膏滴流试验的试验程序，如下所述：

- (1) 将温度试验箱预热至规定的温度；
- (2) 将制备好的试样放入试验箱内，制备好光缆试样一端朝下垂直悬挂。将预先经称重的清洁盛料器皿直接置于（但不能碰）悬挂的试样下；
- (3) 除非另有标准规定时，可按下列步骤对试样进行预处理，否则继续步骤(4)；

① 使温度试验箱内温度达到稳定，除非另有规定，每个试样预处理 1h。

② 预处理结束后，以另一个预先经称重的清洁盛器皿替换原先的那个。对预处理期间使用的盛料器皿称重，记录预处理期间可能滴流的光纤或光缆用阻水油膏量。滴流量大于规定值应作为一次试验失效。除非另有规定，此值应为试样重量的 0.5% 或 0.5g。

③ 通常，试验时间应为 23h，然后继续步骤(5)。

(4) 使箱内温度达到稳定。除非另有规定，试验时间应为 24h；

(5) 试验时间结束后从试验箱内取出盛料皿并对其称重；

(6) 记录每一个试样可能滴流的光纤或光缆用阻水油膏重量，除非另有规定，滴流量不大于 0.005g，作为“无滴流”。试验温度和是否进行预处理应在有关标准中规定。

所有试样中应允许出现一个大于 0.050g 的滴流量。如最初的 5 个试样中有 1 个滴流量大于 0.050g，但小于 0.100g，则应按试样长度和试样制备要求重新制备 5 个追加试样，按试验程序中(1)至(6)进行试验。如追加试样中滴流量无一大于 0.050g，则作为试验合格。

四、油分离和蒸发

1. 目的

油分离和蒸发试验的目的是测量用于与光纤接触的注入阻水油膏高温时的析出和/或蒸发。

2. 试样

用来与光纤接触的填充阻水油膏。

3. 试验装置

油分离和蒸发试验的试验装置由加热温箱、分析天平和吊挂圆锥漏斗等组成。

(1) 一台带自然通风的电加热温箱。

(2) 一架误差极限 $G=0.1\text{mg}$ 的分析天平。

(3) 吊挂圆锥漏斗等试验装置（如图 9.4 所示）的构成如下：

① 一个带金属丝吊钩圆锥漏斗镍金属网，网眼为 60 目（孔数 5.6/mm、金属丝直径 0.19mm、网眼 0.28mm）。圆锥漏斗也可由 60 目不锈钢丝网（网眼 0.25mm）构成。焊线宽大于 1mm。业已证实，两根金属网组成的圆锥漏斗对试验结果无多大的区别。

② 一个 200ml 无倾口的长形烧杯。

③ 一个干燥器。

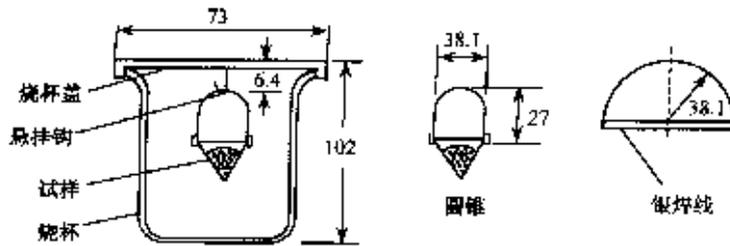


图 9.4 油分离和蒸发试验装置

4. 试验程序

称量干净的烘干烧杯的重量记作 M_1 （称重准确到 1mg），称量配有圆锥漏斗和圆锥漏斗支撑件的烧杯重量记作 M_2 。向圆锥漏斗中加大约 10g 的试样（圆锥漏斗上表面应平滑和凸出，以求流体不被收集，而且在金属网中没有聚积材料）。称量安装好的试验装置和试样的重量记作 M_3 。

将整个试验装置放入温箱内按规定的要求加热并持续一段时间。然后，将整个试验装置从温箱中取出，放入一个干燥器中冷却到室温。再称量整个试验装置重量记作 M_4 。小心地取出圆锥漏斗及其支撑件后，再称量烧杯的重量记作 M_5 。计算出油分离（析油）和蒸发的百分比，报告重复测试平均值。析油和蒸发量的计算式为：

$$\text{油分离 (\%)} = \frac{M_5 - M_1}{M_3 - M_2} \times 100 \quad (9.1)$$

$$\text{油蒸发 (\%)} = \frac{M_3 - M_4}{M_3 - M_2} \times 100 \quad (9.2)$$

油分离和油蒸发的试验结果应不超过规定要求的最大值。

五、气体阻力

1. 目的

气体阻力试验仅适用于气体压力保护非填充光缆。气体阻力试验的目的是检验非填充光缆的气体阻力。

2. 试样

最终的光缆试样长度应满足完成规定的试验要求的长度。

3. 试验装置

气体阻力试验装置由下列几个部分组成:

- (1) 向光缆试样提供稳定气压的空气压缩机;
- (2) 气体流量计;
- (3) 气压表;
- (4) 温度计。

4. 试验程序

测量室温和气压表压力。在室温下,最终的光缆试样的一端连接到一个压力稳定的干燥空气(空气干燥度为 5%RH 或更好)的气源,试样光缆的另一端裸露到大气中。施加到穿过光缆的压力应为 62kPa,其相对容量差为 $\pm 2\%$ 。用一个校正到 $\pm 10\%$ 的气体流量计记录稳定气体流量,也可按特殊用户的要求和有关规定选用其他的气体压力。我们测量的只是那些通过光缆护层内的气路的气流,沿空气流动方向相反的方向做第二测量,分别记录两次的测量结果。可由下式求得气体阻力 F :

$$F = \frac{3720}{f \cdot L} \quad (\text{kPa} \cdot \text{s}/\text{m}^3 \cdot \text{m}) \quad (9.3)$$

式中: L —试样长度 (m);

f —气体流量 (m/s)。

气体阻力应满足有关规定给出的气体阻力的最大值。

六、风积振动

1. 目的

风积振动试验的目的是评价 ADSS 光缆在典型的风积振动条件下,光缆的疲劳性能和光纤的光学特性。

2. 试验装置

风积振动用的试验装置的典型配置和技术保证措施,如图 9.5 所示。两端支座用来给光缆上加张力负载和维持光缆上的张力。被测光缆段安放在两个中间支座之间。如果组合装置能按规定提供足够空间,端头支座和中间支座就不必做成分离装置。截取的受试光缆长度应超过两中间支座间距离,以便于剥去光缆护层和光纤的接入操作。为便于将光缆固定放到两中间支座之间,试样光缆上配有末端或端头金具。在对试样光缆施加张力前,应对试样光缆两端作终接处理,以使光纤不会发生相对于光缆的位移。光缆的张力测量用的是测力计、负载传感器、校正臂或其他装置。风积振动试验中应采取一些措施来保证温度波动条件下光缆受试张力恒定。将受试光缆上张力加至额定的最大安装张力的 100%。

为获得试验结果的重复性,主动作用跨距为两末端金具之间距的三分之二,即大约在悬挂金具所处的位置。主动作用和/或背后跨距也可用更长的距离,见

图 9.5 所示。悬挂金具支撑的高度要确保在主动作用跨距内光缆与水平所成静垂直角为 $1.75 \pm 0.75^\circ$ 。

应提供一些方法来测量和监视自由驻波而不是支撑点处的中间波腹点振幅。用一合适的电控振动器来激振垂直平面上的光缆。振动器的衔铁被牢固地拴在光缆上，以使其与垂直面的光缆垂直。振动器安放在跨内的位置应保证在悬挂金具和振动器之间，最少有六个振动驻波。

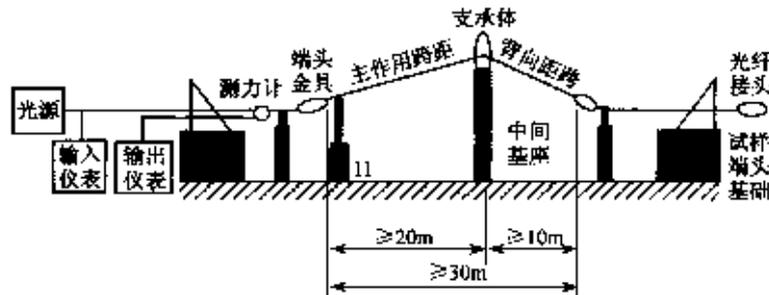


图 9.5 风积振动试验装置

光纤的受试长度（即两终端之间的距离）至少应为 100m，为达到 100m 长度的试验要求，可将几根光纤串联熔接起来。从被测光缆中的一根松套管或一个光纤束中至少抽一根光纤进行试验。应使所做的光纤接头与光设备在同一端。进行光纤光学性能测量所用的光源标称波长值：单模光纤 1550nm，多模光纤 1300nm。

光源被分成两个信号，一个信号接至光功率计作为参考信号，另一个信号与被测光纤自由端相连作为注入信号。从被测光纤输出的信号接至第二个光功率计。整个试验期间，所有的光学和接头都应保持着原封不动状态。

初始光学性能测量应在光缆跨度上预先加张力至大约为最终最大安装张力的 10% 时进行。初始测量的两信号之差给出了一个参考电平，试验中这个信号差的变化将显示出受试光纤的衰减变化。为连续复制记录，测得的信号被输入纸带曲线记录仪。

3. 试验程序

光缆应受到最小 10^8 次循环振动。试验跨度的振动频率，应等于和维持在由 16.1km/h 风速产生的共振频率（即频率 = $82.92 \div$ 光缆直径 (cm)，振幅为光缆直径 / 2）自由波腹点峰与峰振幅应保证等于光缆半径。在开始阶段，应密切注意光缆试验区域。在试验区域稳定前，应每隔 15min 记录一次，在试验区域稳定之后，应每天记录两次（一般是每工作日开始和结束时）数据。

最终测试应在振动完成 2h 后进行，且应重复一次光缆拉伸试验。金具支撑位置处取来的光缆，应加负载到最大额定光缆负载。衰减必须符合有关规定要求。

七、过滑轮

1. 目的

过滑轮试验的目的是验证 ADSS 光缆通过推荐尺寸的架线滑轮和作业过程后光缆没有损伤或光纤光学性能未劣化。

2. 试验装置

过滑轮试验的典型装置，如图 9.6 所示。过滑轮试验应在数米长的光缆试样上进行。端头金具应在试样光缆的 3m 处卡紧。光纤的彼此连接是通过熔接或同样可靠的连接方法实现的。光纤的受试长度至少为 100m。光源与受试光纤的一端相连，受试光纤的另一端用光功率计来监测相对的功率大小。在试验中，光功率计与一个连续工作的纸带曲线记录仪相连接。

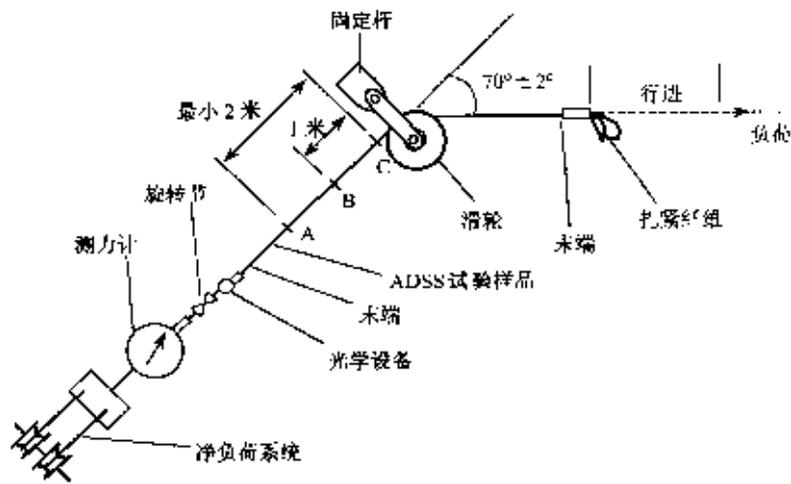


图 9.6 滑轮试验装置

ADSS 光缆制造厂商是按线路角度大小来推荐各种不同直径的架线滑轮。因此，过滑轮试验应按下述试验程序中介绍的，用不同直径滑轮对应的试验线路角进行试验。在试验光缆的终端按 ADSS 光缆制造厂商规定的最大架设张力拉光缆。采用非刚性连接牵引端头方法限制了牵引端处发生扭转的数量。一测力计和一旋转接头安装在卡箍和另一终端之间。

3. 试验程序

最短 2m 的 ADSS 光缆试样过滑轮来回拉 120 次（每个方向 60 次），120 个来回的分配为：拉的角度 70° ，通过次数 120。

ADSS 光缆制造厂商应给拉角所对应的滑轮直径。在开始拉之前，应在试样光缆长度方向的始点、中点和终点作上标记。在第一次通过滑轮前后，每 10 个循环应读取游标卡尺上所示的光缆直径值并作记录。试验中应用监视光功率计连续地监视试样光缆的光功率输出变化。试验完成后，取出受试光缆段，目力检查光缆表面是否有任何损伤。我们也可以剖开光缆来观察其内部结构是否有任何损坏征兆。

通常，光源波长的标称值：单模光纤 1550nm，多模光纤 1300nm。

八、舞动

1. 目的

舞动试验的目的是评定在典型的舞动条件下的 ADSS 光缆的疲劳性能和光纤的光学特性。

2. 试验装置

舞动试验所用的典型装置，如图 9.7 所示。试验装置中的末端金具之间的整个跨度最短为 35m。两端支座用来对光缆施加负载和维持张力。被测光缆段放置在两个中间支座之间。如果组合装置能按规定的装置提供足够的空间，端头和中间支座不必做成分离的装置。截取的受试光缆长度应超过两中间支座间距离，以便于剥去光缆护层和光纤的接入操作。在对试样光缆施加张力前应对光缆两端进行终接，以便光纤不会发生相对于光缆的位移。测量光缆张力的装置是测力计、负载传感器、校正臂或其他装置。舞动试验中应采取一些措施来保证试验中温度波动条件下光缆受试张力不变。然而，舞动本身会引起一些张力波动。向受试光缆所加的张力最小到额定最大安装张力的 50% 或最大加到 4900N。对某些光纤结构，试验张力必须小于 2450N 以便诱发，对这些设计，2450N 试验张力是可以接受的。

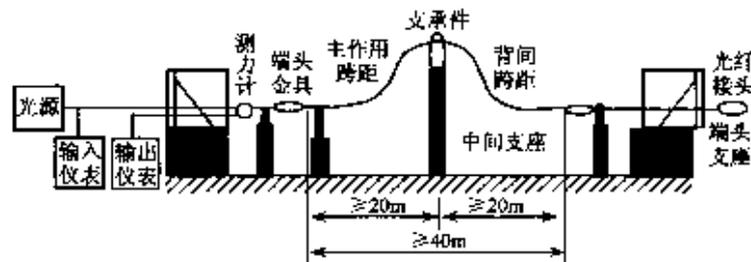


图 9.7 舞动试验装置

一个合适的悬挂金具应放在两端头金具中间的位置。悬挂金具支撑的高度要确保在主动作用跨距内，光缆与水平方向所成的静态垂度角不超过 1° 。

应提供一些方法来测量和监视中间波腹点舞动振幅。用一个合适的振动器来激振垂直平面上的光缆，振动器衔铁被牢固地拴在光缆上。

受试光纤长度（即两终端金具之间的距离）至少应为 100m。为达到 100m 长度的试验要求，可将几根光纤串联熔接起来。从被测光缆中的一根松套管或一个光纤束中至少抽一根光纤进行试验。所做的光纤接头与设备应在同一端。进行光纤光学性能测量所用的光源标称波长值：单模光纤 1550nm，多模光纤 1300nm。

光源被分成两个信号，一个信号连至光功率计作为参考，另一个信号连接到被测光纤自由端作为注入信号。从被测光纤输出的信号连接到第二个光功率计。整个测试期间，所有的光学连接和接头都应保持着原封不动。

初始光学性能测量应在光缆跨度上预先加张力至大约最大安装张力的 5%

时进行。初始测量的两信号之差给出了一个参考电平。试验中这个信号差的变化将显示出受试光纤的衰减变化。为连接复制记录，测得的信号输入纸带曲线记录仪。

3. 试验程序

试样光缆至少应经受 10^5 次循环舞动。试验跨距的振动频率应是单驻波共振频率。在进行测量的主动跨距内，驻波波腹峰与峰的振幅与驻波长度之比应保持在 $1/25$ 。

试验中的机械和光学数据大约每 2000 个循环阅读和记录一次。光功率计应在试验开始前 1 小时和试验结束后 2 小时进行连续监视。最终的光学性能测量应在振动完成后至少 2 小时以后才能进行。

九、耐电痕

1. 目的

耐电痕试验的目的是验证在电场和机械应力共同作用下，ADSS 光缆外护层耐侵蚀和耐电痕作用的能力。

2. 试验装置

从生产线上取下一段一定长度的光缆试样。在将光缆试样水平放置到盐雾室内两个固定点之前，应先将其两端头密封，以防湿气浸入试样光缆。这样做可以保证受试光缆上的机械应力加至盐雾试验条件要求的初始应力值。接地终端的情况应该与光缆制造厂家建议的光缆用于支持铁塔上的服役情况十分接近。接地终端可由如螺旋缠绕夹紧线与任何合适的消除机械或电应力的附件共同组成。这种高压终端装置应由光缆制造厂家选定。

光缆试样地盐雾试验装置中的两终端间的受测长度必须足够长，以避免在盐雾试验中发生飞弧。通常，合适的试样长度为 25mm/kV 。用一弹簧拉紧受试光缆，以求在试验中的光缆材料的任何蠕变都不会引起明显的张力减小。试验中检查张力的合适间隔为 100 小时一次。只要张力变化大于初始张力值的 10%，那么应将张力再次调整至试验张力范围内。

在盐雾室内，借助合适数目的雾化喷嘴产生电导盐雾，盐雾室内雾化喷嘴数选择的实用准则是按盐雾室体积算，2.5 立方米一个喷嘴。至雾化喷嘴的盐水应由 NaCl 和蒸馏去离子水配制的。雾化喷嘴喷出的雾滴大小为 $5\sim 20\mu\text{m}$ ，喷嘴上的气压为 3.3bar。雾化喷嘴应沿盐雾室四周均匀地分布，使盐雾室获得盐雾密度均匀，且盐雾滴不应直接喷射到光缆试样上。为使盐雾室内的空气自然排出，盐雾室应开一个不大于 80cm^2 的孔。试验用的一台工频试验变压器的最小连续额定电流为 250mA，跳闸电流为 1A。受试光缆对地距离至少为 300mm。

3. 试验程序

光缆拉紧后，应用在水中浸湿的毛巾或纸巾擦洗光缆，随后才对受试光缆进行盐雾试验。盐雾试验条件如下：

试验持续时间: 1000h
盐水流速: 0.4 ± 0.1 L/h (每立方米盐雾室体积)
雾滴大小: $5 \sim 20 \mu\text{m}$
温度: $15 \sim 25^\circ\text{C}$
盐水中的 NaCl 含量: 10 ± 0.5 kg/m³
试验电压和频率: 与用户商定

含 NaCl 的盐水不允许循环使用。为了检查光缆张力, 允许试验中断几次, 但每次中断的时间不应超过 15min。中断时间 (如典型 100 小时) 不计入试验持续时间。

十、阻燃

1. 目的

阻燃试验的目的是确定光缆遭受火焰燃烧时, 火焰的蔓延是否仅在限定范围内, 残焰残灼是否在限定时间内能自行熄灭, 光缆在火焰中燃烧一定时间内是否能保证正常通信的性能。

阻燃试验方法是按光缆敷设方式和光缆根数可以为两种, 单根垂直燃烧和成束燃烧。对于通信光缆的燃烧性能的试验方法常常按照光缆是单根敷设或成束安装分别选用单根垂直和成束燃烧试验来评定阻燃光缆的阻燃性能。

2. 试验装置

光缆成束燃烧试验装置, 如图 9.8 所示, 试验设备有: 燃烧试验箱、钢梯和火源等。

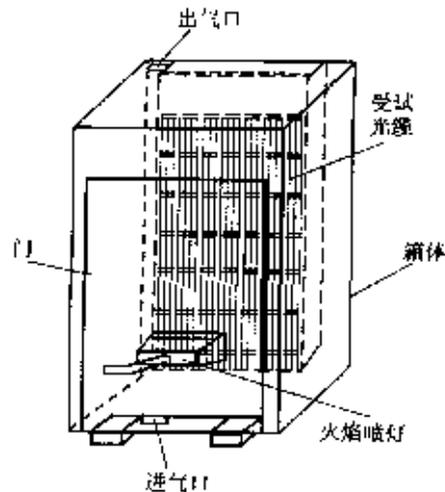


图 9.8 光缆成束燃烧试验装置

(1) 燃烧试验箱

燃烧试验箱的内部尺寸为宽 1000 ± 100 mm、深 2000 ± 100 mm 和高 4000 ± 50 mm。

(2) 钢梯

安装试样的钢梯用钢管焊接制成，钢梯宽 $500 \pm 5\text{mm}$ ，高 $3500 \pm 10\text{mm}$ ，梯子沿高度方向分为 9 级。

(3) 火源

火源宜采用带型喷灯，用丙烷作燃料。

3. 试验程序

成束燃烧试验的程序是先按光缆每米长度所含非金属材料的体积不同为 A、B、C、D 四类，再根据每米光缆金属的总体积除以某类每米光缆非金属材料的总体积计算出试样根数取整数（ ≥ 0.5 取 1）。然后将一定根数的试样（每根 3.5m 长）按彼此紧挨或互相留有规定间隙的方法安放在钢梯上，用 0.5~1.0mm 的金属线将试样绑扎在梯子的每一级横档上，安装试样应在梯宽中部，其总宽度应不超过 30mm，光缆束的任一边与梯子立柱的间距应不小于 50mm。随后启动消烟除尘器，点燃喷灯，按规定 20min 供火时间用喷灯火焰燃烧试样，在燃烧完全停止后，检查试样损坏的程度，即试样碳化部分所达到的高度小于 2.5m 则可判定试验结果为合格。